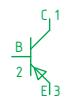


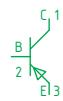
Leitfaden zum GM328A einem Instrument zum identifizieren und messen von elektronischen Bauteilen und elektrischen Einheiten.

Version 1.13k
aber auch
1.56m

1 —||— 3
329pF

Karl-Heinz Kübbeler
kh_kuebbeler@web.de
&
Markus Reschke
madires@theca-tabellaria.de


BJT-PNP
hFE=226
Ie=1.6mA
Ube=673mV+


BJT-PNP
hFE=226
Ie=1.6mA
PIN 1=C 2=B 3=E

1 —□— 3
0.1Ω L=.05mH

Zusammengestellt
von bm-magic

13. November 2025

1 —△— 3
Uf=670mV
25pF-17pF @0-5V
Ir=.80μA

1 —□— 2
2205 Ω

1 —□— 3
10.08 kΩ


N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
RDS=.2Ω +


N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
3 —△— 2 Uf=598mV+


N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
PIN 1=G 2=D 3=S

13.05.2019/MOR

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	6
1.1	Einleitung	6
1.1.1	HINWEIS!	6
1.2	Sicherheitshinweise	6
1.3	Lizenz	6
1.3.1	Zusätzliche Hinweisei zur Lizenz	6
1.4	Versions Unterschiede	6
1.4.1	Spezifikation	6
2	Hardware	7
2.1	Beschreibung	7
2.1.1	Unten dem gleichen Namen gibt es eine „neue“ Version	8
2.2	Die Bedienung	8
2.2.1	Taster	8
2.2.2	Drehencoder	9
3	Eigenschaften	10
3.0.1	Auswahlmenü	12
3.1	Wichtige Bemerkungen	12
3.2	Problemfälle	12
4	Funktionsmenü in der k-Version	13
4.1	Optionale Menüfunktionen	13
4.2	Selbsttest und Kalibration	16
5	Funktionsmenü in der m-Version	18
5.0.1	Einschalten	18
5.0.2	Bauteilesuche	18
5.0.3	Batterieüberwachung	18
5.0.4	Ausschalten	19
5.1	Menü	19
5.1.1	PWM-Generator	19
5.1.2	Einfache PWM	20
5.1.3	Erweiterte PWM	20
5.1.4	Rechteck-Signalgenerator	20
5.1.5	Zerertest (Hardware-Option)	20
5.1.6	Logiktester (Hardware-Option)	21
5.1.7	Durchgangsprüfer (Hardware-Option)	21
5.1.8	ESR-Tool	22
5.1.9	Kondensatorleckstrom	22
5.1.10	R/C/L-Monitore	22
5.1.11	L/C-Meter (Hardware-Option)	22
5.1.12	Frequenzzähler (Hardware-Option)	23

5.1.13	Einfacher Zähler	23
5.1.14	Erweiterter Zähler	23
5.1.15	Klingeltester (Hardware-Option)	24
5.1.16	Ereigniszähler (Hardware-Option)	24
5.1.17	Drehencoder	25
5.1.18	Kontrast	25
5.1.19	Detektor/Decoder für IR-Fernbedienungen	25
5.1.20	IR-Fernbedienung	26
5.1.21	Opto-Koppler-Test	27
5.1.22	Fotodioden-Test	28
5.1.23	Dioden/LED-Schnelltest	28
5.1.24	Modellbau-Servo-Test	28
5.1.25	OneWire-Scan	29
5.1.26	DS18B20/DS18S20 OneWire Temperatursensoren	29
5.1.27	DHTxx-Temperatur & Luftfeuchte-Sensoren	29
5.1.28	MAX6675/MAX31855	30
5.1.29	BH1750 Umgebungslichtsensor	30
5.1.30	INA226 Leistungsmonitor	30
5.1.31	Licht	31
5.1.32	Voltmeter 0-5 V DC	31
5.1.33	Selbsttest	32
5.1.34	Selbstabgleich	32
5.1.35	Speichern/Laden	33
5.1.36	Werte anzeigen	33
5.1.37	Zeichensatz/Symbole	33
5.1.38	Ausschalten	33
5.1.39	Exit	33
6	Programm Code	34
6.1	In der k-Version	34
6.2	In der m-Version	34
6.3	Makefile	34
6.3.1	MCU-Typ	34
6.3.2	MCU-Taktfrequenz	34
6.3.3	Oszillator-Typ	34
6.3.4	Avrdude MCU-Typ	35
6.3.5	Avrdude ISP-Programmierer	35
6.4	config.h	36
6.4.1	Hardware Einstellungen	36
6.4.2	Nun folgt die Qual der Wahl	36
6.4.3	Software Einstellungen	37
6.4.4	Benutzer Einstellungen	40
6.4.5	Energieverwaltung	42
6.4.6	Messeinstellungen und Offsets	43
6.4.7	Busse	44
6.5	Config_328.h	45
6.5.1	Notwendige Änderungen für Display	45
6.5.2	Notwendige Änderungen für Drehgeber und Optionen	46
6.5.3	Information	47
7	Programmieren des Testers	48
7.1	Konfigurieren des Component Testers	48
7.2	Programmierung des Mikrocontrollers	48
7.3	Betrieb System Linux	48
7.4	Benutzung unter Linux	49

7.5	Programm Pakete installieren	49
7.6	Download der Quellen	49
7.7	Benutzung der Schnittstellen	49
7.8	Gruppen Mittgliedschaft	50
7.9	Arbeitsumgebung	50
7.10	Firmware erzeugen und übertragen	51
7.11	Arbeitsumgebung vereinfachen	52
7.12	Nötige Hardware zum Programmieren	52
7.12.1	Programmer	52
8	Technische Daten	54
8.1	Hilfe	54
8.2	Und für Entspannung	54
8.3	Schema GM 328 A	55

Vorwort

Grundsätzliches Jeder Bastler kennt das folgende Problem: Man baut einen Transistor aus oder man nimmt einen aus einer Bastelkiste. Wenn man die Typenbezeichnung erkennen kann und man bereits ein Datenblatt hat oder eins bekommen kann, ist alles in Ordnung. Aber wenn man keine Datenblätter findet, hat man keine Idee, was das für ein Bauteil sein kann. Mit den konventionellen Messmethoden ist es schwierig und zeitaufwändig den Typ des Bauteils und dessen Parameter herauszufinden. Es könnte ein NPN, PNP, N- oder P-Kanal-MOSFET usw. sein. Es war die Idee von Markus F., diese Arbeit von einem AVR-Mikrocontroller erledigen zu lassen.

vorhergehende Sätze sind abgeschrieben aus der Transistor Tester Einleitung von Karl-Heinz Kübbeler. Eigentlich stammt ein großer Teil dieses Dokuments aus Auszügen seiner Arbeit, **...bei dem ich mich hiermit bedanken möchte...**

Mein Kontakt mit diesem Tester war rein zufällig. Als ich billige Teile für mein neues Projekt suchte, fand ich ihn bei chinesischen Lieferanten zu einem Preis, der unter dem hiesigen Preis für das Display lag. Nachdem ich den Tester bekam und ich den Batterieanschluss verlötet hatte, war ich überhaupt nicht überrascht, als das Display dunkel blieb. Der Verkäufer, den ich kontaktiert habe, hat mir eine ...-Adresse gesendet:

<https://www.youtube.com/watch?v=0bfxyy1K3po>, und als ich sah, wie der Prüfer den Encoder drückte, schämte ich mich ... und war gleichzeitig

erstaunt was diese kleine Platinchen alles kann. Beim ersten Einschalten wurde ich zu einer Kalibrierung geführt, die so organisiert ist, dass kein Fehler gemacht werden kann. Weiter wurde mir auch Folgendes mitgeteilt: ... <svn://mikrocontroller.net/transistortester> wo ich die komplette Dokumentation bekommen habe, in der ich gelesen habe, dass es verschiedene Bedienungssprachen gibt.

In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich beschlossen, ihm deutsch beizubringen. An dieser Stelle sollte ich hinzufügen, dass ich beim Kauf des Testers am Anfang 2018 73 Jahre alt war.

- Eigentlich begann es, als ich mit 72 beschloss, dass es Zeit ist, Programmieren zu lernen. Vor über 30 Jahren habe ich (zu dieser Zeit in Eile) einen Ereignis Zähler gebaut, der mir immer noch einen guten Service bietet. Wie es aussieht, lebt Notbehelf am längsten ... dennoch, habe ich entschieden, als mein erstes Projekt diesen Zähler in Software zu entwerfen. Ich habe einen AVR-Kurs mit einem Kit gekauft und abgearbeitet, aber wie die meisten Kurse endete es mit LEDs einzuschalten und mit denen eine Ampel für Fußgänger zu machen.

Bei der ersten Problemen, wandte ich mich an den Autor (khk), der mich geduldig (innerhalb von ca. drei Monaten) in ca. 50 Mails soweit gebracht hatte, dass der Tester sogar Tschechisch sprechen kann. Aus Dankbarkeit versprach ich, seine Dokumentation ins Tschechische zu übersetzen. In weiteren E-Mails stellte mir khk LaTex vor, in dem diese Dokumentation geschrieben ist.

Die tschechische Übersetzung, stellte ich mir vor, wie eine Puppe einen Krieg. Schon nach den ersten fünf Sätzen wurde mir klar, dass vor 50 Jahren als in nach Deutschland kam, keine Informatik gab und dass ich, alle Fachbegriffe NUR in Deutsch oder Englisch kann. Der Versuch, mit Google zu übersetzen, verlief sehr schlecht. Ich brauchte also für 130 Seiten fast ein Jahr. Als ich fertig war, hatte khk aus persönlichen Gründen keine Zeit, deshalb hat er meine Arbeit noch nicht veröffentlicht ...

Software für den Tester entwickelt von Anfang an ein weiterer Entwickler, Markus Reschke. Seine Software ist sehr interessant, aber die Konfiguration ist nicht so gut beschrieben. (Es gibt "nur-* .txt und das noch meistens in Englisch).

- Um sie besser zu verstehen, habe ich sie nach *.pdf konvertiert. Der Autor hat die Konvertierung auf seiner [?] Website veröffentlicht.

...auch diesem Entwickler möchte ich hiermit danken...

1.1. Einleitung

Der Tester basiert auf dem Projekt von Markus Frejek [?] und der Weiterführung von Karl-Heinz Kübbeler [?] und Markus Reschke [?].

Beiden Entwickler haben ihre Werke gut dokumentiert.

In folgendem werden Auszüge aus ihren Dokumenten verwendet.

Bitte, lies bestimmt die Originale.

1.1.1. HINWEIS! Leider kann der Originalzustand der chinesischen Software-Variante nicht gesichert werden, da die Sicherheits-Bits des ATmega328 gesetzt sind. Es gibt also keinen Weg zurück zur Originalversion der Software.

Vorschlag: Da dieses Model eine DIP Version des ATmega328P auf Sockel verwendet, kannst Du das Original aufbewahren und, je nach Einsatz, verschiedene Konfigurationen auf neue ATmega328P brennen. ;-)

1.2. Sicherheitshinweise

Der Tester ist kein Multimeter!

Es ist ein einfacher Tester für Bauteile, der verschiedene Parameter messen kann.

Die Eingänge sind nicht geschützt und werden durch Spannungen über 5V beschädigt.

Den Tester nicht für Schaltungen in Betrieb nutzen, sondern nur für einzelne Bauteile!

Bei Kondensatoren darauf achten, dass sie entladen sind, bevor der Tester angeklemmt wird.

Benutzung auf eigene Gefahr!

1.3. Lizenz

Der Autor der Ursprungsversion hat bzgl. der Lizenzbedingungen nur zwei Vorgaben gemacht.

Zum einen ist das Projekt Open Source, und zum anderen sollen sich kommerzielle Benutzer beim Autor melden.

Unglücklicherweise haben beide Entwickler den ursprünglichen Autor bisher nicht erreichen können.

Um das Problem des Fehlens einer vernünftigen Open-Source-Lizenz zu lösen, wurde am 1.1.2016 eine Standard-Open-Source-Lizenz ausgewählt, nachdem der ursprüngliche Autor ausreichend Zeit hatte, uns seine Wünsche bzgl. einer Lizenz mitzuteilen.

Da diese Firmwareversion eine komplett neue Version ist, die lediglich ein paar Ideen der ursprünglichen Firmware aufgreift, aber keinen Code teilt, sollte dieses Vorgehen gerechtfertigt sein.

Lizenziert unter der EUPL V.1.1

1.3.1. Zusätzliche Hinweisei zur Lizenz

Produkt- oder Firmennamen können geschützte Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

1.4. Versions Unterschiede

Während die Firmware von Karl-Heinz die offizielle Version ist und auch ältere ATmega MCUs unterstützt, ist die Markus Version zum Ausprobieren und Testen neuer Ideen gedacht. Außerdem ist sie auf ATmegas mit mindestens 32kB Flash beschränkt.

1.4.1. Spezifikation Beide Versionen sind für den Einsatz in verschiedenen Testern mit unterschiedlicher Hardware konzipiert. Einige Optionen können in diesem Tester nicht verwendet werden, zumindest nicht ohne Hardwaremodifikation.

Andererseits bietet die Software so viele Möglichkeiten, dass sie die Kapazität des ATmega-Speichers übersteigt.

Es ist also meistens nicht möglich, gleichzeitig alle Optionen zu testen.

2.1. Beschreibung

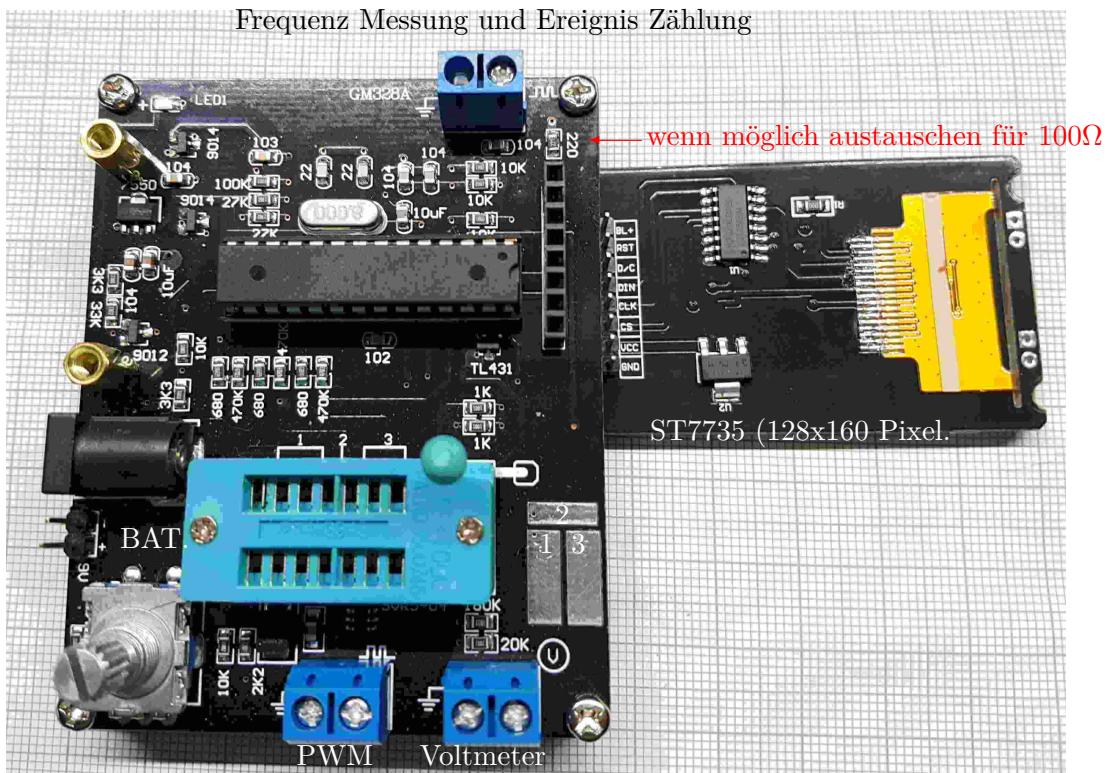


Abbildung 2.1. Ansicht mit abgenommenem LCD Display

- Wie schon aus dem erkennbar verwendet dieser Tester ATmega 328 P mit DIP Sockel, was externes Programmieren erlaubt, was auch nötig ist, weil es kein ISP Anschluss gibt.

Die Platine ist mit einem 8MHz Quarz bestückt, wobei die Nachrüstung eines Trimmers (genauere Frequenz) möglich ist.

- Das Gerät verwendet ein Farbdisplay mit ST7735 Controller (128x160 Pixel).

Wie es auf dem Bild ?? rechts oben gut sichtbar ist, verwendet Display einen CD4050 (IC1) Puffer für die Anpassung der Signalpegel und einen 3.3V Spannungsregler (IC2) für die Spannungsversorgung.

Austausch des Widerstandes für die Hintergrundbeleuchtung kann die Lesbarkeit verbessern.

- Externe 2,5V Referenc ist durch TL431 realisiert.

- Auf der Platine ist ein Netzteil Anschluss und vorbereitete Lötaugen für 9V Batterie.

- Zum bedienen ist ein Drehcodear mit Taster vorhanden.

- Die Testpins sind über 14 poligen Textool Anschluss zugänglich, für SMD Bauteile ist hier eine Testunterlage.

- Wie man auf dem Schema sieht ?? auf Seite ?? sind die Testpins durch Dioden Array IC SRV05-4 (IC2) teilweise geschützt, denn ein absoluter Schutz ist nicht möglich.

- Tester bietet über ein Klemmenpaar (X2) einen Frequenzausgang. Dieser geht aber lediglich parallel zu TP_2.

- Ein weiterer Anschluss (X3) dient zur messen von positiven DC Gleichspannung bis max 50V. Dieser Eingang bietet keinen Schutz!.

- Und eine dritte Doppelklemme (X4) bietet, ohne Schutz, einen Frequenzeingang.

2.1.1. Unten dem gleichen Namen gibt es eine „neue“ Version in der ein ATMega328 32 Pin MLF verbaut ist.

Ausgeliefert wird dieser Tester mit einer „alter“ Version 1.12k von Karl-Heinz Kübbeler. [?] Weil der ATMega fest verlötet ist, wird die Umprogrammierung erschwert, aber nicht unmöglich. Glücklicherweise ist die programmier Schnittstelle vorhanden und wie im Bild rechts belegt. Zum Stromversorgung ist USBc gedacht, was ebenfalls nicht sehr praktisch ist. Glücklicherweise ist die Möglichkeit vorhanden um eine 9 V Zelle nachzulöten. Weil der Abstand der Punkten nur 1,27 mm beträgt, wird für die Herstellung des Adapters eine „ruhige“ Hand nötig. Details siehe Seite ??.

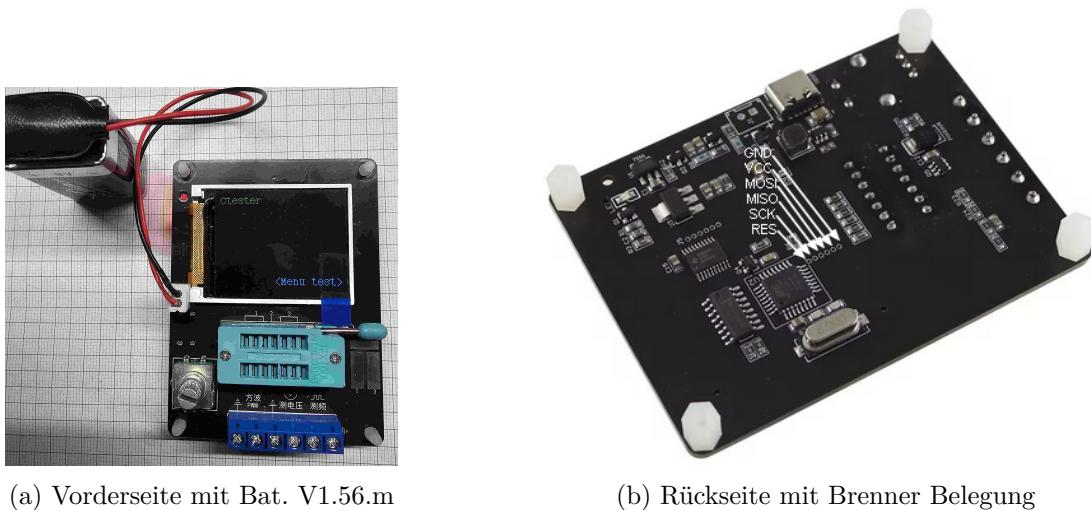


Abbildung 2.2. GM328A "neu"

2.2. Die Bedienung

ist realisiert durch einen Impulsdrehgeber mit Drucktaster und ist relativ einfach. Trotzdem sind einige Hinweise erforderlich. In jedem Fall kannst du Bauteile mit drei Anschlüssen mit den drei Testports in beliebiger Reihenfolge verbinden. Bei zweipoligen Bauteilen kannst du die beiden Anschlüsse mit beliebigen Testports verbinden. Normalerweise spielt die Polarität keine Rolle, auch Elektrolytkondensatoren können beliebig angeschlossen werden. Die Messung der Kapazität wird aber so durchgeführt, dass der Minuspol am Testport mit der kleineren Nummer liegt. Da die Messspannung aber zwischen 0,3V und maximal 1,3V liegt, spielt auch hier die Polarität keine wichtige Rolle. Wenn das Bauteil angeschlossen ist, sollte es während der Messung nicht berührt werden. Lege es auf einen isolierenden Untergrund ab, wenn es nicht in einem Sockel steckt. Berühre auch nicht die Isolation der Messkabel, das Messergebnis kann beeinflusst werden.

Nun sollte der Starttaster gedrückt werden.

Was hier geschieht, hängt von der Softwarekonfiguration ab.

Damit ein Vergleich möglich ist wurden hier gleiche Konfigurationen und Zeiten benutzt.

2.2.1. Taster schaltet den Tester ein und dient zur **Bedienung**. Im automatischen Modus wartet Tester 30 Sec auf ein Bauteil ... bevor ... für die Batterie Schonung, abschaltet. Falls ist, in dieser Zeit, ein Bauteil eingelegt ist, benehmen sich die Versionen **unterschiedlich**. **In der m-Version** schaltet Tester konsequent nach 30 Sec ab aber du kannst durch längerer Druck früher beenden.

- Eine neue Messung erreichst du mit einem kurzen Druck oder durch drehen des Enkoders nach rechts.
- Und das Auswahlmenü durch Doppeldruck oder durch drehen nach links.

Tester unterscheidet zwischen:

1. **kurzen Tastendruck**, der üblicherweise zum Fortfahren einer Funktion oder zur Auswahl des nächsten Menüpunktes benutzt wird,
2. **langen Tastendruck** ($> 0,3\text{s}$), der eine kontextabhängige Aktion ausführt und
3. **Doppelklick** der die Aktion beendet.

Wenn der Tester einen Tastendruck zum Fortfahren der aktuellen Aktion erwartet, zeigt es dies durch einen Cursor rechts unten auf dem LCD-Modul an.

Ein statischer Cursor signalisiert, dass weitere Informationen folgen, und ein blinkender Cursor bedeutet, dass mit der Bauteilesuche weiter gemacht wird.

Für einige Funktionen wird der Cursor nicht angezeigt, da die erwartete Eingabe klar sein sollte.

In der k-Version schaltet der Tester **nicht aus**, sondern wartet auf den nächsten Bauteil, denn dann automatisch testet.

Zum ausschalten ist ein Tastendruck oder schnelles drehen, in beliebigen Richtung, nötig.

- Auswahlmenü erreichst nach dem einschalten **ohne** eines eingelegten Bauteils durch ein langes Druck ($> 0.5\text{s}$) oder durch ein schnelles drehen des Drehencoders.

2.2.2. Drehencoder verleiht dem Tester zusätzliche Funktionalität, die kontextabhängig ist. Manche Funktionen erlauben über die Drehgeschwindigkeit größere Änderungen oder Sprünge von Werten. Der Lese-Algorithmus berücksichtigt die Anzahl der Gray-Code-Pulse pro Schritt und auch die Anzahl der Schritte für eine volle 360° Umdrehung. Die Erkennung der Drehgeschwindigkeit misst die Zeit von zwei Schritten.

Also solltest Du den Encoder mindestens um zwei Schritte für mittlere Geschwindigkeit drehen. Für höhere Geschwindigkeiten sind es drei Schritte.

Ein einzelner Schritt resultiert immer in der niedrigsten Geschwindigkeit. Details kannst du direkt in der Dokumentation des Autoren erfahren. Siehe [?].

Kapitel 3

Eigenschaften

1. Automatische Erkennung von NPN und PNP bipolaren Transistoren, N- und P-Channel MOSFETs, JFETs, Dioden, Doppeldioden, N- und P-IGBTs, Thyristoren und Triacs. Für Thyristoren und Triacs müssen die Zünd- und Halteströme für die richtige Erkennung erreicht werden können. Bei IGBTs muß die Gate Schwellwertspannung unter 5V liegen.
2. Darstellung der Pin-Belegung der erkannten Bauteile.
3. Messung des Stromverstärkungsfaktors und der Basis-Emitter-Schwellspannung für bipolare Transistoren.
4. Darlington-Transistoren können durch die höhere Schwellspannung und durch den hohen Stromverstärkungsfaktor erkannt werden.
5. Automatische Erkennung einer Schutzdiode bei bipolaren Transistoren und bei MOSFETs.
6. Messung der Schwellwert-Spannung, der Gate-Kapazität und des R_{DSon} bei einer Gatespannung von knapp 5V von MOSFETs.
7. Bis zu zwei Widerstände werden gemessen und mit den  Symbolen und den Widerstands-Werten mit bis zu vier Dezimalstellen in der richtigen Dimension angezeigt. Alle Symbole werden eingerahmt mit den gefundenen Testpin Nummern des Testers (1-3). Deshalb können auch Potentiometer gemessen werden. Wenn der Schleifer eines Potentiometers auf eine Endposition gestellt ist, kann der Tester nicht mehr zwischen mittlerem Anschluss und Endanschluss unterscheiden.
8. Die Auflösung der Widerstandsmessung ist jetzt bis zu $0,01\Omega$, Werte von bis zu $50M\Omega$ werden erkannt.
9. Ein Kondensator kann erkannt und gemessen werden. Der wird mit dem Symbol  und dem Kapazitätswert mit bis zu vier Dezimalstellen in der richtigen Dimension angezeigt. Der Wert kann zwischen $25pF$ (bei $8MHz$ Takt, $50pF$ bei $1MHz$ Takt) bis $100mF$ liegen. Die Auflösung kann bis zu $1pF$ (bei $8MHz$ Takt) betragen.
10. Bei Kondensatoren mit einer Kapazität über $20nF$ wird zusätzlich der äquivalente Serienwiderstand (ESR) des Kondensators mit einer Auflösung von $0,01\Omega$ gemessen und mit zwei Dezimalstellen angezeigt. Diese Fähigkeit steht nur zur Verfügung, wenn der ATmega mindestens 16K Flashspeicher besitzt.
11. Für Kondensatoren mit einem Kapazitätswert über $5000pF$ kann der Spannungsverlust Vloss nach einem Ladepuls bestimmt werden. Der Spannungsverlust gibt einen Hinweis auf die Güte des Kondensators.
12. Bis zu zwei Dioden werden mit dem Symbol  oder dem Symbol  in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Zusätzlich werden die Schwellspannungen angezeigt.
13. Eine LED wird als Diode erkannt, die Schwellspannung ist viel höher als bei einer normalen Diode. Doppeldioden werden als zwei Dioden erkannt.
14. Zener-Dioden können erkannt werden, wenn die Zener-Spannung unter $4,5V$ ist. Sie werden als zwei Dioden angezeigt, man kann das Bauelement nur mit den Spannungen erkennen. Die äußeren Testpin-Nummern, welche die Dioden Symbole umgeben, sind in diesem Fall identisch. Man kann die wirkliche Anode der Diode nur durch diejenige Diode herausfinden, deren Schwellwert-Spannung nahe bei $700mV$ liegt!
15. Wenn mehr als 3 Dioden erkannt werden, wird die gefundene Anzahl der Dioden zusammen mit der Fehlermeldung angezeigt. Das kann nur passieren, wenn Dioden an alle drei Test-Pins angeschlossen sind und wenigstens eine eine Zener-Diode ist. In diesem Fall sollte man nur zwei Test-Pins anschließen und die Messung erneut starten, eine Diode nach der anderen.
16. Der Kapazitätswert einer einzelnen Diode in Sperr-Richtung wird automatisch ermittelt. Bipolare Transistoren können auch untersucht werden, wenn nur die Basis und entweder Kollektor oder Emitter angeschlossen wird.
17. Die Anschlüsse einer Gleichrichter-Brücke können mit nur einer Messung herausgefunden

werden.

18. Kondensatoren mit Kapazitätswerten von unter $25pF$ werden normalerweise nicht erkannt, aber sie können zusammen mit einer parallel geschalteten Diode oder mit einem parallel geschaltetem Kondensator mit wenigstens $25pF$ gemessen werden. In diesem Fall muss der Kapazitätswert des parallel geschalteten Bauteils vom Messergebnis abgezogen werden. Bei Prozessoren mit mindestens 32K Flash Speicher wechselt der Tester mit einem Kondensator $> 25pF$ an TP1 und TP3 in eine Kondensator-Meßfunktion, die auch Kapazitäten ab $1pF$ direkt mißt.
19. Bei Widerständen unter 2100Ω wird auch eine Induktivitätsmessung durchgeführt. Dabei wird zusätzlich zum Widerstands-Symbol ein Induktivitäts Symbol angezeigt. Der Anzeigebereich ist etwa $0,01mH$ bis über $20H$, die Genauigkeit ist allerdings nicht hoch. Das Ergebnis wird nur bei einem Einzelwiderstand zusammen mit dem Widerstandswert angezeigt.
20. Die Messzeit beträgt ungefähr zwei Sekunden, nur Kapazitätssmessungen und Induktivitätsmessungen können länger dauern.
21. Die Software kann für Messserien mit vorgebbarer Wiederhol-Zahl konfiguriert werden, bevor die automatische Abschaltung ausschaltet.
22. Eingebaute Selbsttest-Funktion inklusive einem optionalen $50Hz$ Frequenz-Generator um die Genauigkeit der Taktfrequenz und der Verzögerungszeiten zu überprüfen.
23. Wählbare Möglichkeit den Nullabgleich für die Kondensatormessung und die Innenwiderstände für die Portausgänge beim Selbsttest automatisch zu bestimmen. Ein externer Kondensator mit einer Kapazität zwischen $100nF$ und $20\mu F$ an Pin 1 und Pin 3 ist notwendig, um die Offset-Spannung des analogen Komparators zu kompensieren. Dies kann den Messfehler bei Kapazitätssmessungen bis zu $40\mu F$ reduzieren. Mit dem gleichen Kondensator wird eine Korrekturspannung zum Einstellen der richtigen Verstärkung für die ADC Messung mit der internen $1,1V$ Referenzspannung berechnet.
24. Anzeige des Kollektor-Emitter-Reststroms I_{CE0} mit stromloser Basis ($1\mu A$ Auflösung) und des Kollektor-Emitter Reststroms I_{CES} mit der Basis auf Emitter-Potential gehalten. Diese Werte werden nur angezeigt, wenn sie nicht Null sind (besonders für Germanium-Transistoren).
25. Der Tester wechselt vom Multifunktionstest zu einem Modus als Widerstands-Messgerät, wenn bei der automatischen Bauteile-Erkennung nur ein Widerstand an Test Pin 1 (TP1) und Test Pin 3 (TP3) erkannt wird. Wenn in der Makefile auch die Induktivitätsmessung beim Widerstandsmessgerät mit der Option RMETER_WITH_L gewünscht wurde, werden bei der Widerstandsmessung auch Induktivitäten gemessen. Der Betriebsmodus wird durch [R] oder [RL] auf der rechten Seite von Zeile 1 des Displays angezeigt. Genau so wechselt der Tester zu einem Kapazitätssmessgerät, wenn bei der Bauteile-Untersuchung ein Kondensator an TP1 und TP3 erkannt wurde. Dieser Betriebsmodus wird durch [C] auf der rechten Seite der Zeile 1 angezeigt. In dieser Betriebsart können Kondensatoren ab $1pF$ gemessen werden. Lediglich für den automatischen Start der Funktion braucht man einen Kondensator mit mehr als $25pF$. Beide Sonderfunktionen können durch einen Tastendruck beendet werden. Der Tester fährt dann mit der normalen Messfunktion fort.
26. Es kann eine Dialogfunktion gewählt werden, die weitere Einsatzmöglichkeiten zugänglich machen kann. Natürlich kann über den Dialog auch zu der Transistortester-Funktion zurückgekehrt werden.
27. Mit Dialogfunktion kann am PD4-Port eine Frequenzmessung vorgenommen werden. Die Auflösung beträgt bei Eingangsfrequenzen über $33kHz$ ein Hertz. Bei niedrigeren Frequenzen kann die Auflösung bis zu $0,001mHz$ betragen. Lesen Sie bitte das Unterkapitel 2.2.4 in der Dokumentation [?], wie ein Frequenzsignal angeschlossen werden muss.
28. Mit Dialogfunktion und ohne serielle Ausgabe kann eine externe Spannung bis $50V$ über einen 10:1 Spannungsteiler am PC3 Pin gemessen werden.
29. Mit Dialogfunktion kann eine Frequenzausgabe auf dem TP2-Pin (PB2-Port des ATmega) erfolgen. Derzeit können von Frequenzen von $1Hz$ bis $2MHz$ eingestellt werden.
30. Mit Dialogfunktion kann eine feste Frequenz mit einstellbarer Puls weite auf dem TP2-Pin (PB2-Port des ATmega) ausgegeben werden. Die Breite kann mit kurzem Tastendruck um 1% und mit längerem Tastendruck um 10% erhöht werden.

31. Mit der Dialogfunktion kann eine spezielle Kondensatormessung mit ESR-Messung gestartet werden. Die Funktion wird bei der Auswahl C+ESR@TP1:TP3 genannt. Kapazitäten ab etwa $2\mu F$ bis zu $50mF$ können meistens wegen der geringen Messspannung von etwa $300mV$ im eingebauten Zustand gemessen werden.
32. Es kann der ADC mit der Sampling-Methode so genutzt werden, daß Kondensatoren unter $100pF$ mit einer Auflösung von $0.01pF$ gemessen werden können. Mit der gleichen Methode können auch Spulen unter $2mH$ mit deutlich besserer Auflösung über die Resonanzfrequenz mit einem parallelgeschalteten Kondensator bekannter Größe bestimmt werden.
33. Die Batterieüberwachung kann nach deinem Wünschen eingestellt werden. Jeder Zyklus beginnt mit der Anzeige der Batteriespannung und des Status (ok, schwach, leer). Fällt die Batteriespannung unter die Schwellenspannung fällt, schaltet sich das Prüfgerät ab. Die Batterie wird auch während des Betriebs überprüft.

3.0.1. Auswahlmenü bietet weitere Möglichkeiten des Testers. Diese Funktionen sind, je nach der benutzten Version unterschiedlich. Manche Funktionen mit dem gleichen oder ähnlichen Namen, unterscheiden sich im Umfang und Bedienung. Genaue Beschreibung findest du direkt in der jeweiligen Einleitung. Siehe [?].

3.1. Wichtige Bemerkungen

Stelle immer sicher, dass **Kondensatoren** vor dem Anschluss an den Tester **entladen** sind! Der Tester könnte sonst beschädigt werden bevor er eingeschaltet ist. Es gibt nur wenig Schutzfunktion der ATmega-Anschlüsse. Besondere Vorsicht ist auch geboten, wenn versucht wird, Bauelemente in einer Schaltung zu messen. Das Gerät sollte in jedem Fall vorher von der Stromeinspeisung getrennt sein und man sollte sicher sein, dass **keine Restspannung** im Gerät vorhanden ist. Beim Messen kleiner Widerstandswerte muss man besonders auf die Übergangswiderstände achten. Es spielt die Qualität und der Zustand von Steckverbindern eine große Rolle, genau so wie die Widerstandswerte von Messkabeln. Dasselbe gilt auch für die Messung des ESR-Wertes von Kondensatoren. Bei schlechten Anschlusskabeln mit Krokodilklemmen wird so aus einem ESR von $0,02\Omega$ leicht ein Wert von $0,61\Omega$. Wenn möglich sollte man Kabel mit Testklemmen an die drei Testports parallel zu vorhandenen Sockeln fest anschließen (anlöten). Dann braucht der Tester für kleine Kapazitäten nicht jedesmal neu kalibriert werden, wenn mit oder ohne eingesteckte Testkabel gemessen wird. Für die Kalibration des Nullwiderstandes macht es aber im allgemeinen einen Unterschied, ob die Testpins direkt am Sockel oder am Ende der Kabel mit den Testklemmen verbunden wird. Nur im letzteren Fall ist der Widerstand von Kabel und Klemmen mit kalibriert. Im Zweifelsfall kann man die Kalibration mit dem Kurzschluß am Testsockel durchführen und danach den Widerstand der kurzgeschlossenen Klemmen mit dem Tester messen.

3.2. Problemfälle

Bei den Messergebnissen sollten Sie immer im Gedächtnis behalten, dass die Schaltung des Transistorstesters für Kleinsignal-Bauelemente ausgelegt ist. Normalerweise beträgt der maximale Messstrom etwa $6mA$. Leistungshalbleiter machen oft wegen hoher Restströme Probleme bei der Erkennung oder beim Messen der Sperrschicht-Kapazität. Bei Thyristoren und Triacs werden oft die Zündströme oder die Halteströme nicht erreicht. Deswegen kann es vorkommen, dass ein Thyristor als NPN-Transistor oder Diode erkannt wird. Ebenso ist es möglich, dass ein Thyristor oder Triac gar nicht erkannt wird.

Probleme bei der Erkennung machen auch Halbleiter mit integrierten Widerständen. So wird die Basis-Emitter-Diode eines BU508D-Transistors wegen eines parallel geschalteten internen 42Ω Widerstandes nicht erkannt. Folglich kann auch die Transistorfunktion nicht geprüft werden. Probleme bei der Erkennung machen oft auch Darlington-Transistoren höherer Leistung. Hier sind auch oft Basis-Emitter-Widerstände verbaut, welche die Erkennung wegen der hier verwendeten kleinen Messströme erschweren.

Kapitel 4 *Funktionsmenü in der k-Version*

Normalerweise wird beim Start des Testers für eine Sekunde die Batteriespannung angezeigt. Wenn die Spannung eine Grenze unterschreitet, wird eine Warnung hinter der Batteriespannung ausgegeben. Wenn Sie eine aufladbare 9V-Batterie benutzen, sollten Sie den Akku möglichst bald austauschen oder nachladen. In der zweiten Zeile die gemessene Betriebsspannung mit „VCC=x.xxV“ angezeigt.

Einzelmessung Wenn der Tester für Einzelmessung konfiguriert ist (POWER_OFF-Option), schaltet der Tester nach einer Anzeigezeit von 28 Sekunden (konfigurierbar) wieder automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Während der Anzeigezeit kann aber auch vorzeitig eine neue Messung gestartet werden. Nach der Abschaltung kann natürlich auch wieder eine neue Messung gestartet werden, entweder mit dem gleichen Bauteil oder mit einem anderen Bauteil.

Dauermessung Einen Sonderfall stellt die Konfiguration ohne die automatische Abschaltfunktion dar. Hierfür wird die POWER_OFF-Option in der Makefile nicht gesetzt. Diese Konfiguration wird normalerweise nur ohne die Transistoren für die Abschaltung benutzt. Es wird stattdessen ein externer Ein-/Aus-Schalter benötigt. Hierbei wiederholt der Tester die Messungen solange, bis ausgeschaltet wird.

Serienmessung In diesem Konfigurationsfall wird der Tester nicht nach einer Messung sondern erst nach einer konfigurierbaren Zahl von Messungen abgeschaltet. Hierfür wird der POWER_OFF-Option in der Makefile eine Wiederholzahl (z.B. 5) zugewiesen. Im Standardfall wird der Tester nach fünf Messungen ohne erkanntes Bauteil abgeschaltet. Wird ein angeschlossenes Bauteil erkannt, wird erst bei der doppelten Anzahl, also zehn Messungen abgeschaltet. Eine einzige Messung mit nicht erkanntem Bauteil setzt die Zählung für erkannte Bauteile auf Null zurück. Ebenso setzt eine einzige Messung mit erkannten Bauteil die Zählung für die nicht erkannten Bauteile auf Null zurück. Dies hat zur Folge, dass auch ohne Betätigung des Starttasters immer weiter gemessen werden kann, wenn Bauteile regelmäßig gewechselt werden. Ein Bauteilwechsel führt in der Regel durch die zwischenzeitlich leeren Klemmen zu einer Messung ohne erkanntes Bauteil.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Betriebsmodus für die Anzeigezeit. Wenn beim Einschalten der Starttaster nur kurz gedrückt wurde, beträgt die Anzeigezeit der Messergebnisse nur 5 Sekunden. Wenn der Starttaster bis zum Erscheinen der ersten Meldung festgehalten wurde, beträgt die Anzeigezeit wie bei der Einzelmessung 28 Sekunden. Ein vorzeitiger neuer Messbeginn ist aber während der Anzeigezeit durch erneutes Drücken des Starttasters möglich.

4.1. Optionale Menüfunktionen

Wenn die Menüfunktion eingeschaltet ist, startet der Tester nach einem längeren Tastendruck ($> 0.5s$) ein Auswahlmenü für zusätzliche Funktionen. Die wählbaren Funktionen erscheinen in Zeile 4 als gekennzeichnete Funktion. Dabei wird die vorige und nächste Funktion in Zeile 3 und 5 angezeigt. Nach einer längeren Wartezeit ohne jegliche Bedienung kehrt das Programm zu der normalen Transistor-Tester-Funktion zurück. Durch kurzen Tastendruck kann zur nächsten Auswahl gewechselt werden. Mit einem längeren Tastendruck startet die angezeigte Zusatzfunktion. Nach Anzeige der letzten Funktion „Schalte aus“ wird wieder die erste Funktion angezeigt.

Die Menü-Auswahl kann auch mit einem schnellen Drehen des Encoders während der Anzeige einer vorausgegangenen Messung aufgerufen werden. Die Menüfunktionen können mit einem langsamen Drehen des Encoders in beliebiger Richtung ausgewählt werden. Die ausgewählte Menüfunktion kann aber nur mit einem längeren Tastendruck gestartet werden. Innerhalb einer Menüfunktion können Parameter durch eine langsame Drehung des Encoders ausgewählt wer-

den. Eine schnelle Drehung des Encoders kehrt zur Menü-Auswahl zurück.

Frequenz Die Zusatzfunktion „Frequenz“ (Frequenzmessung) benutzt als Eingang den PD4-Pin des ATmega, der auch an das LCD angeschlossen ist. Es wird immer zunächst die Frequenz gemessen, bei Frequenzen unter 25kHz wird auch die mittlere Periode des Eingangssignals bestimmt und daraus die Frequenz mit einer Auflösung von bis zu $0,001\text{Hz}$ berechnet. Bei gesetzter POWER_OFF-Option in der Makefile wird die Dauer der Frequenzmessung auf 8 Minuten beschränkt. Die Frequenzmessung wird durch Tastendruck beendet und in das Auswahlmenü zurückgekehrt.

f-Generator Bei der Zusatzfunktion „f-Generator“ (Frequenz-Generator) können die Frequenzen zwischen 1Hz und 2MHz gewählt werden. Die Einstellung der Frequenz kann jeweils nur für die höchste dargestellte Stelle (Ziffernposition) verändert werden. Für die Stellen 1Hz bis 10kHz sind jeweils die Ziffern 0-9 wählbar. Bei der 100kHz Stelle ist 0-20 wählbar. In Spalte 1 der Frequenzzeile wird durch ein $>$ oder $<$ Symbol angezeigt, ob durch einen längeren Tastendruck ($> 0.8\text{s}$) zur höheren oder niedrigen Stelle geschaltet wird. Zur niedrigeren Stelle ($<$) kann nur geschaltet werden, wenn die augenblickliche Stelle auf 0 gestellt wurde und wenn nicht die Stelle mit 1Hz Schritten gewählt wurde. Bei der gewählten 100kHz Stelle ist das $>$ Symbol durch ein R Zeichen ersetzt. Der längere Tastendruck bewirkt dann eine Rücksetzung der Frequenz auf den Startwert 1Hz. Bei gesetzter POWER_OFF-Option in der Makefile muss für den Frequenzwechsel die Taste länger gedrückt werden, da durch einen kurzen Tastendruck ($< 0.2\text{s}$) nur die Zeitüberwachung von 4 Minuten zurückgesetzt wird. Die abgelaufene Zeit wird in Zeile 1 durch einen Punkt für jede abgelaufene 30 Sekunden angezeigt. Durch einen regelmäßigen kurzen Tastendruck kann die vorzeitige Abschaltung der Frequenzerzeugung verhindert werden. Ein längerer Tastendruck ($> 2\text{s}$) kehrt wieder zur Auswahl der Funktionen zurück.

10-bit PWM Bei der Zusatzfunktion „10-bit PWM“ (Pulsweitenmodulation) wird eine feste Frequenz mit einstellbarer Pulsweite an Pin TP2 erzeugt. Mit einem kurzen Tastendruck ($< 0.5\text{s}$) wird die Pulsweite um 1% erhöht, mit einem längeren Tastendruck um 10%. Bei Überschreiten von 99% werden 100% vom erhöhten Wert abgezogen. Bei gesetzter POWER_OFF-Option in der Makefile wird die Frequenzerzeugung nach 8 Minuten ohne Bedienung beendet. Durch sehr langen Tastendruck ($> 1,3\text{s}$) kann die Frequenzerzeugung auch beendet werden.

C+ESR@TP1:3 Bei der Zusatzfunktion „C+ESR@TP1:3“ wird eine separate Kondensatormessung mit ESR-Messung an TP1 und TP3 gestartet. Messbar sind Kondensatoren mit mehr als $2\mu\text{F}$ bis zu 50mF . Wegen der geringen Messspannung von etwa 300mV sollte in vielen Fällen die Messung in der Schaltung ohne vorherigen Ausbau möglich sein. Bei gesetzter POWER_OFF-Option in der Makefile ist die Anzahl der Messungen auf 250 beschränkt, kann aber sofort wieder gestartet werden. Die Mess-Serie kann durch einen längeren Tastendruck beendet werden.

Widerstandsmeßgerät Mit dem 1— 3 Symbol wird der Tester in ein Ohmmeter an TP1 und TP3 verwandelt. Diese Betriebsart wird durch ein [R] in der rechten Ecke der ersten Displayzeile angezeigt. Weil bei dieser Betriebsart die ESR-Meßfunktion nicht benutzt wird, beträgt auch für Widerstände unter 10Ω die Auflösung nur 0.1Ω . Wenn die Ohmmeter Funktion mit der Induktivitätsmessung konfiguriert wurde, erscheint hier ein 1— 3 Symbol. Dann beinhaltet die Ohmmeter Funktion die Messung von Induktivitäten für Widerstände unter 2100Ω . In der rechten Ecke der ersten Zeile des Displays wird dann ein [RL] angezeigt. Für Widerstände unter 10Ω wird dann auch die ESR-Meßmethode benutzt, wenn keine Induktivität festgestellt wurde. Damit erhöht sich die Auflösung für Widerstände unter 10Ω auf 0.01Ω . In dieser Betriebsart werden die Meßwerte fortlaufend ermittelt. Mit einem Tastendruck beendet der Tester diese Betriebsart und kehrt wieder zum Menü zurück. Die gleiche Betriebsart wird auch automatisch gestartet, wenn zwischen TP1 und TP3 ein einzelner Widerstand angeschlossen wurde und der Start-Taster gedrückt wurde. In diesen Fall kehrt der Tester mit einem Tastendruck wieder zu der normalen Teseterfunktion zurück.

Kondensatormeßgerät Mit dem 1— 3 Symbol wird der Tester in ein reines Kondensator-

Meßgerät an TP1 und TP3 verwandelt. Die Betriebsart wird durch ein [C] in der rechten Ecke der ersten Zeile des Displays angezeigt. Bei dieser Betriebsart können Kondensatoren ab 1pF bis zu 100mF gemessen werden. In dieser Betriebsart werden die Meßwerte fortlaufend ermittelt. Mit einem Tastendruck wird dieser Sonderbetrieb beendet und der Tester kehrt wieder zum Menü zurück. Auch hier wird wie bei der Widerstands-Meßfunktion in den Betriebs-Modus automatisch gewechselt, wenn zwischen TP1 und TP3 ein Kondensator mit der normalen Testerfunktion gemessen wurde. Der Tester kehrt nach dem automatischen Start wieder zu der normalen Testerfunktion zurück, wenn der Taster gedrückt wird.

Impulsdrehgeber Mit der Zusatzfunktion „Impulsdrehgeber“ kann ein Drehgeber untersucht werden. Die drei Kontakte des Impulsdrehgebers müssen vor dem Start der Zusatzfunktion beliebig an die drei Testpins des Transistortesters angeschlossen werden. Nach dem Start der Funktion muss der Drehknopf nicht zu schnell gedreht werden. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen ist, wird die Pinbelegung der Kontakte symbolisch in Zeile 2 dargestellt. Dabei wird der gemeinsame Anschluss herausgefunden und für etwa zwei Sekunden angezeigt, ob an den Raststellung beide Kontakte offen ('o') oder beide Kontakte geschlossen ('C') sind. Ein Impulsdrehgeber mit offenen Kontakten an den Raststellungen wird so mit der Zeile 2 „1-/-2-/-3 o“ zwei Sekunden lang angezeigt. Natürlich wird die richtige Pinnummer des gemeinsamen Kontaktes in der Mitte anstelle der '2' angezeigt. Wenn auch die geschlossene Schalterstellung an den Raststellungen vorkommt, wird außerdem in Zeile 2 „1—2—3 C“ zwei Sekunden lang angezeigt. Mir ist kein Impulsdrehgeber bekannt, der immer nur geschlossene Kontakte an jeder Raststellung hat. Die Stellungen der Kontakte zwischen den Raststellungen werden nur kurz ($< 0,5\text{s}$) ohne die Kennbuchstaben 'o' oder 'C' in Zeile 2 angezeigt. Wenn der Impulsdrehgeber für die Bedienung des Testers eingesetzt werden soll, muß die Makefile Option WITH_ROTARY_SWITCH=2 für Drehgeber mit nur den offenen Kontakten ('o') und die Option WITH_ROTARY_SWITCH=1 für Drehgeber mit offenen ('o') und geschlossenen ('C') Kontakten an den Raststellungen.

C(μF)-Korrektur Mit dieser Menüfunktion kann ein Korrekturwert für die Messung gröserer Kapazitätswerte geändert werden. Die Funktion ist die gleiche, die auch mit der Makefile Option C_H_KORR voreingestellt werden kann. Werte über Null reduzieren den Ausgabewert der Kapazität um diesen Prozent Wert, Werte unter Null würden den Ausgabewert anwachsen lassen. Ein kurzer Tastendruck verringert den Korrekturwert um 0.1%, ein längerer Tastendruck vergrößert den Korrekturwert um 0.1%. Ein sehr langer Tastendruck speichert den Wert. Es ist eine Eigenschaft des Meßverfahrens, daß Kondensatoren mit geringer Güte wie Elektrolyt-Kondensatoren mit zu großer Kapazität gemessen werden. Erkennbar ist die Güte über den Parameter Vloss. Gute Kondensatoren haben kein Vloss oder nur 0.1%. Zum Abgleich dieses Parameters sollten also nur Kondensatoren mit über $50\mu\text{F}$ hoher Güte verwendet werden. Übrigens halte ich die Bestimmung des exakten Kapazitätswertes von Elektrolyt-Kondensatoren für überflüssig, da die Kapazität sowohl von der Temperatur als auch der DC-Spannung abhängt.

Selbsttest Mit der Zusatzfunktion „Selbsttest“ wird ein vollständiger Selbsttest mit Kalibration durchgeführt. Dabei werden sowohl die Testfunktionen T1 bis T7 (wenn nicht verhindert mit der Option NO_TEST_T1_T7) als auch die Kalibration mit dem externen Kondensator jedes Mal durchgeführt.

Spannung Die Zusatzfunktion „Spannung“ (Spannungsmessung) ist nur möglich, wenn die serielle Ausgabe deaktiviert wurde. Da am Port PC3 ein 10:1-Spannungsteiler vorgesehen ist, können Spannungen bis 50V gemessen werden. Bei gesetzter POWER_OFF-Option in der Makefile und ohne Bedienung wird die Messung nach 4 Minuten beendet. Die Messung kann aber durch einen besonders langen Tastendruck (> 4 Sekunden) vorher beendet werden.

FrontColor dient dazu, die Schriftfarbe anpassen zu können. Du kannst eine der drei Farben rot, grün und blau mit einem längeren Tastendruck wählen. Die Intensität der gewählten Farbe, die mit einem > Zeichen in Spalte 1 gekennzeichnet wird, kann durch Drehen des Impulsdrehgebers verändert werden.

BackColor ist, wie Menü zu vor zuständig für personalisieren der Hintergrundfarbe.

Zeige Daten Die Funktion „Zeige Daten“ zeigt neben der Software-Versionsnummer die Daten des Abgleichs an. Dies sind die Nullwiderstände R0 von Pin 1:3, 2:3 und 1:2 . Außerdem werden die Ausgangswiderstände der Ports zur 5V-Seite (RiHi) und zur 0V Seite (RiLo) angezeigt. Die Nullkapazitätswerte (C0) werden ebenfalls in allen Pinkombinationen angezeigt (1:3, 2:3, 1:2 und 3:1, 3:2 2:1). Danach werden auch die Spannungskorrekturen für die Komparatorspannung (REF_C) und für die Referenzspannung (REF_R) angezeigt. Bei Graphikdisplays werden danach noch die verwendeten Symbole für die Bauteile und der Fontsatz angezeigt. Jede Seite wird 15 Sekunden angezeigt. Es kann aber auch durch Tastendruck oder einer Rechtsdrehung des Impulsdrehgebers zur nächsten Seite geblättert werden. Mit einer Linksdrehung des Impulsdrehgebers kann die Ausgabe wiederholt werden oder zur vorigen Seite zurückgeblättert werden.

Schalte aus Mit der Zusatzfunktion „Schalte aus“ kann der Transistortester abgeschaltet werden.

Transistor Natürlich kann mit der Funktion „Transistor“ (Transistortester) wieder zu der normalen Transistortester-Funktion zurückgekehrt werden.

Bei gesetzter POWER_OFF-Option in der Makefile sind alle Zusatzfunktionen zeitbeschränkt, damit die Batterie nicht verbraucht wird.

4.2. Selbsttest und Kalibration

Wenn die Software mit der Selbsttestfunktion konfiguriert ist, kann der Selbsttest durch einen Kurzschluss aller drei Testports und Drücken der Starttaste eingeleitet werden. Für den Start des Selbsttests muss die Starttaste innerhalb von 2 Sekunden noch einmal gedrückt werden, sonst wird mit einer normalen Messung fortgefahrene. Beim Selbsttest werden die im Kapitel 5 des Transistortesters [?] beschriebenen Tests ausgeführt. Wenn der Tester mit einer Menüfunktion (Option WITH_MENU) konfiguriert ist, wird der vollständige Selbsttest mit den Tests T1 bis T7 nur bei dem „Selbsttest“ ausgeführt, der als Menüfunktion ausgewählt werden kann. Außerdem wird beim Aufruf über die Menüfunktion der Abgleich mit dem externen Kondensator durchgeführt, sonst nur für den ersten Aufruf. Damit kann der durch die kurzgeschlossenen Testports automatisch gestartete Abgleich schneller durchgeführt werden. Die viermalige Testwiederholung bei T1 bis T7 kann vermieden werden, wenn der Starttaster gedrückt gehalten wird. So kann man uninteressante Tests schnell beenden und sich durch Loslassen des Starttasters interessante Tests viermal wiederholen lassen. Der Test 4 läuft nur automatisch weiter, wenn die Verbindung zwischen den Testports gelöst wird.

Wenn die Funktion AUTO_CAL in der Makefile gewählt ist, wird beim Selbsttest eine Kalibration der Nullwertes für die Kondensatormessung durchgeführt. Für die Kalibration des Nullwertes für die Kondensatormessung ist wichtig, dass die Verbindung zwischen den Testpins (Kurzschluss) während des Tests 4 wieder gelöst wird! Sie sollten während der Kalibration (nach dem Test 6) weder die Testports noch angeschlossene Kabel berühren. Die Ausrüstung sollte aber die gleiche sein, die später zum Messen verwendet wird. Andernfalls wird der Nullwert der Kondensatormessung nicht richtig bestimmt. Die Kalibration des Innenwiderstandes der Port-Ausgänge wird mit dieser Option vor jeder Messung durchgeführt.

Bei der Kalibration werden zwei Sonderschritte gemacht, wenn die samplingADC Funktion in der Makefile gewählt wurde (WITH_SamplingADC = 1). Nach der normalen Bestimmung der Nullwerte der Kapazitätsmessung werden dann auch die Nullwerte mit der Sampling Methode (C0samp) bestimmt. Als letzter Teil der Kalibration wird der Anschluß eines Testkondensators für die Spulenmessung an Pin 1 und Pin 3 angefordert mit der Meldung 1—||— 3 10-30nF(L). Der Kapazitätswert sollte hierbei zwischen 10nF und 30nF liegen, um eine meßbare Resonanzfrequenz bei der späteren Parallelschaltung mit einer Spule (< 2mH) zu erreichen. Für Spulen mit mehr als 2mH Induktivität sollte die normale Testfunktion ohne die Parallelschaltung eines Kondensators ausreichen. Ein Parallelschalten des Kondensators sollte hier nicht mehr zu einer Verbesserung des Meßergebnisses führen.

Nach der Bestimmung der Nullkapazitäten ist der Anschluß eines Kondensators mit einer beliebiger Kapazität zwischen 100nF und 20μF an Pin 1 und Pin 3 erforderlich. Dazu wird

in Zeile 1 ein 1—||— 3>100nF angezeigt. Sie sollten den Kondensator erst nach der Ausgabe der C0 Werte oder nach der Ausgabe dieser Aufforderung anschließen. Mit diesem Kondensator wird die Offset-Spannung des analogen Komparators kompensiert, um genauere Kapazitätswerte ermitteln zu können. Die Verstärkung für ADC-Messungen mit der internen Referenz-Spannung wird ebenfalls mit diesem Kondensator abgeglichen, um bessere Widerstands-Messergebnisse mit der AUTOSCALE_ADC-Option zu erreichen. Wenn die Menüfunktion beim Tester ausgewählt wurde (Option WITH_MENU) und der Selbsttest nicht als Menüfunktion gestartet wurde, wird der Abgleich mit dem externen Kondensator nur bei der ersten Kalibration durchgeführt. Die Kalibration mit dem externen Kondensator kann nur wiederholt werden, wenn der Selbsttest als Menüfunktion ausgewählt wird.

Der Nullwert für die ESR-Messung wird als Option ESR_ZERO in der Makefile vorbesetzt. Mit jedem Selbsttest wird der ESR Nullwert für alle drei Pinkombinationen neu bestimmt. Das Verfahren der ESR-Messung wird auch für Widerstände mit Werten unter 10Ω benutzt um hier eine Auflösung von $0,01\Omega$ zu erreichen.

Kapitel 5 *Funktionsmenü in der m-Version*

5.0.1. Einschalten Ein langer Tastendruck beim Einschalten aktiviert den Auto-Hold-Modus. In diesem Modus wartet der Tester nach einer Ausgabe auf einen kurzen Tastendruck, um mit der Bauteilesuche weiter zu machen.

Um die erste Bauteilesuche nach dem Einschalten im diesem Modus zu überspringen, gibt es die Option UI_SKIP_FIRST_PROBING. Siehe Config.h Zeile ??.

Ansonsten läuft der Tester im kontinuierlichen Modus. Die Auswahl des Modus lässt sich per config.h (UI_AUTOHOLD) umdrehen.

Nach dem Einschalten wird kurz die Firmwareversion angezeigt.

Mit einem sehr langen Tastendruck (2 s) beim Einschalten, kannst Du die Abgleich-werte auf ihre Standards zurück setzen.

- Das kann praktisch sein, wenn z.B. der Kontrast vom LCD-Modul so verstellt ist, dass man nichts mehr sieht.

Wenn der Tester ein Problem mit den gespeicherten Abgleichwerten entdeckt (Problem mit dem EEPROM), zeigt er einen Prüfsummenfehler an und benutzt stattdessen die Firmware-Standardwerte.

Bei einem Tester mit einem manuellen Ein/Aus-Schalter statt dem Soft-Latch- Schalter der Referenzschaltung, bitte POWER_SWITCH_MANUAL in config.h aktivieren. In diesem Fall kann sich der Tester leider nicht selbst abschalten.

Es gibt eine Option, um nach dem Einschalten in das Hauptmenü zu gehen, wenn zuvor beim Einschalten die Testtaste zweimal gedrückt wurde (UI_MAINMENU_POWERON_BUTTON). Die Dauer der ersten Tastenbetätigung bestimmt weiterhin den Betriebmodus.

5.0.2. Bauteilesuche Wenn UI_SKIP_FIRST_PROBING Option nicht gewählt wurde, sucht Tester nach dem Einschalten automatisch nach Bauteilen.

Im kontinuierlichen Modus wiederholt der Tester die Suche nach einer kurzen Wartepause.

Wenn mehrfach hintereinander kein Bauteil gefunden wurde, schaltet sich der Tester aus.

Im Auto-Hold-Modus (durch Cursor signalisiert) führt der Tester einen Suchvorgang aus und wartet dann auf einen Tastendruck bzw. Rechtsdrehung vom Drehencoder bevor er die nächste Suche startet.

Die Wartepause und das automatische Abschalten im kontinuierlichen Modus kann mittels CYCLE_DELAY und CYCLE_MAX auf Siehe Config.h Zeile ?? geändert werden.

Für den Auto-Hold-Modus gibt es eine optionale automatische Abschaltung (POWER_OFF_TIMEOUT) Seite ??, welche nur während der Bauteilesuche, Ergebnisausgabe und im Hauptmenü aktiv ist.

In beiden Modi kannst Du das Hauptmenü aufrufen (siehe weiter unten).

Ist die Summer/Pieper-Option vorhanden, kannst Du einen kurzen Bestätigungston für das Ende der Bauteilesuche aktivieren (UI_PROBING_DONE_BEEP). Daneben gibt es auch eine Option zum temporären Umschalten in den Auto-Hold-Modus nachdem ein Bauteil erkannt wurde (im kontinuierlichen Modus, UI_AUTOHOLD_FOUND).

Dies hilft beim Lesen der Ergebnisausgabe.

Eine weitere Option (UI_PROBES13_RCL) startet automatisch den RCL-Monitor, wenn ein R, C oder L an den Testpins 1 und 3 angeklemmt ist.

5.0.3. Batterieüberwachung Jeder Zyklus der Bauteilesuche beginnt mit der Anzeige der Batteriespannung und des Status (ok, schwach, leer). Bei Unterschreiten der Schwellenspannung für eine leere Batterie schaltet sich der Tester aus. Die Batterie wird regelmäßig während des Betriebs überprüft.

Die Standardkonfiguration der Batterieüberwachung ist für eine 9 V-Batterie ausgelegt, kann aber an fast jede andere Stromversorgung angepasst werden. Im Abschnitt „power management“ in config.h findest Du alle Einstellungen dazu auf Seite ??.

Die Batterieüberwachung kann mittels BAT_NONE deaktiviert werden, auf direkte Messung für Batterien mit weniger als 5 V per BAT_DIRECT konfiguriert werden, oder auf indirekte Messung über einen Spannungsteiler (definiert durch BAT_R1 und BAT_R2) gesetzt werden.

Manche Tester unterstützen zwar eine optionale externe Stromversorgung, aber erlauben keine Überwachung dieser.

In diesem Fall kannst Du per BAT_EXT_UNMONITORED Probleme mit dem automatischen Abschalten bei zu niedriger Batteriespannung umgehen.

Bei externer Stromversorgung wird der Batteriestatus dann auf „ext“ (für extern) gesetzt. Die Schwellwerte für eine schwache und leere Batterie werden über BAT_WEAK und BAT_LOW gesetzt, während BAT_OFFSET den Spannungsverlust durch die Schaltung definiert, z.B. Verpolungsschutzdiode und PNP-Transistor zum Schalten der Stromversorgung.

5.0.4. Ausschalten Während das Ergebnis der letzten Bauteilesuche angezeigt wird, schaltet ein langer Tastendruck den Tester aus. Dabei zeigt der Tester ein kurzes „Auf Wiedersehen“ oder „Ciao!“ und schaltet sich dann selbst ab. Allerdings bleibt der Tester solange noch eingeschaltet, wie die Taste gedrückt gehalten wird. Das liegt am Design des Schaltungsteils der Stromversorgung.

Du kannst die Anzeige eines kleinen Batteriesymbols für den Batteriestatus anstatt der textbasierten Variante aktivieren (UI_BATTERY). Auch gibt es die Möglichkeit, den Batteriestatus in der letzten Zeile nach der Ergebnisausgabe anzuzeigen (UI_BATTERY_LASTLINE).

5.1. Menü

Durch zweimaliges kurzes Drücken der Test-Taste nach der Ausgabe des letztes Ergebnisses gelangt man in das Menü. Einfach zweimal kurz hintereinander drücken. Kann vielleicht etwas Übung am Anfang benötigen ;)

Wenn ein Drehencoder vorhanden ist, startet zusätzlich eine Linksdrehung das Menü. Die alte Methode über den Kurzschluss der drei Testpins kann ebenfalls aktiviert werden (UI_SHORT_CIRCUIT_MENU).

Im Menü wählt ein kurzer Tastendruck den nächsten Punkt aus und ein langer Tastendruck führt den ausgewählten Punkt aus. Bei einem LCD-Modul mit 2 Zeilen wird unten rechts eine Navigationshilfe angezeigt. Ein „>“, wenn weitere Punkte folgen, oder ein „<“ beim letzten Punkt.

Geht man weiter als der letzte Punkt, gelangt man wieder zum ersten. Bei einem LCD-Modul mit mehr als 2 Zeilen wird der ausgewählte Punkt mit einem „*“ davor gekennzeichnet.

Ist ein Drehencoder vorhanden, wird mit dem Drehen der vorherige bzw. nächste Punkt ausgewählt. Hier gibt es auch wieder einen Überlauf, d.h. vom ersten zum letzten Punkt.

Ein kurzer Tastendruck führt den Punkt aus, im Gegensatz zu oben. Normalerweise springt der Tester nach dem Ausführen einer Funktion wieder zur Bauteilsuche zurück. Wenn du lieber im Menü bleiben möchtest, kannst du UI_MAINMENU_AUTOEXIT abschalten. Das Menü wird dann über ein explizites „Exit“ beendet.

Manche Punkte/Extras zeigen beim Start das Pin-out der benutzten Testpins kurz an. Die Info wird für ein paar Sekunden gezeigt, kann aber mit einem kurzen Tastendruck übersprungen werden.

Funktionen, welche Signale erzeugen, geben ihr Signal standardmäßig auf Testpin #2 aus. Dabei werden die Pins #1 und #3 auf Masse gesetzt.

Ist Dein Tester für die Signalausgabe auf einem eigenen Ausgang (OC1B) konfiguriert, werden die Testpins nicht genutzt und es erfolgt auch keine Ausgabe des Pinout.

5.1.1. PWM-Generator Macht genaus das, was Du erwartest :-) Vor dem Übersetzen der Firmware bitte entweder den PWN-Generator mit einfacher Bedienung oder den mit erweiterter Bedienung auswählen. Letzterer benötigt einen Drehencoder und ein größeres Display. Für die

optionale Ausgabe der Pulsdauer zusätzlich PWM_SHOW_DURATION aktivieren.

Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

Pin #2: Ausgang (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Pin #1 und #3: Masse

5.1.2. Einfache PWM Zuerst muss man aus einer vorgegebenen Liste die Frequenz wählen. Kurzer Tastendruck für die nächste Frequenz und langer Tastendruck zum Starten, wie beim Menü.

Mit Drehencoder ein kurzer Tastendruck zum Starten.

Das Tastverhältnis startet bei 50 % und kann in 5 %-Schritten geändert werden.

Ein kurzer Tastendruck für +5 % und ein langer für -5 %.

Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

Ist ein Drehencoder vorhanden, lässt sich das Tastverhältnis in 1 %-Schritten ändern.

5.1.3. Erweiterte PWM Mit einem kurzen Tastendruck schaltest Du zwischen Frequenz und Tastverhältnis um.

Der ausgewählte Wert wird durch ein Sternchen markiert.

Mit dem Drehencoder änderst Du den Wert, rechts für höher, links für niedriger.

Und mit einem langen Tastendruck wird auf den Standardwert zurück gestellt (Frequenz: 1 kHz, Tastverhältnis: 50 %).

Mit zwei kurzen Tastendrückern wird der PWM-Generator beendet.

5.1.4. Rechteck-Signalgenerator Der Signalgenerator gibt ein Rechtecksignal mit variabler Frequenz bis zu einem 1/4 des MCU-Taktes aus (2 MHz bei 8 MHz Takt). Die Startfrequenz liegt bei 1000 Hz und kann mit dem Drehencoder geändert werden.

Die Drehgeschwindigkeit bestimmt den Grad der Änderung, d.h. langsames Drehen ergibt kleine Änderungen und schnelles Drehen große.

Da die Signalerzeugung auf der internen PWM-Funktion der MCU basiert, können nicht beliebige Frequenzen generiert werden, sondern nur in Schritten. Für niedrige Frequenzen ist die Schrittweite recht klein, erst bei hohen Frequenzen wird sie signifikant.

Ein langer Tastendruck stellt die Frequenz zurück auf 1 kHz und zwei kurze Tastendrücke beenden den Signalgenerator.

Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

Pin #2: Ausgang (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Pin #1 und #3: Masse

Hinweis: Drehencoder oder andere Eingabeoption notwendig!

5.1.5. Zenertest (Hardware-Option) Mit Hilfe eines DC-DC-Konverters wird eine Testspannung von bis zu 50 V zum Testen von Zenerdioden generiert. Der Anschluss erfolgt über zusätzliche Testpins. **Solange die Test-Taste gedrückt wird, erzeugt der Konverter die Testspannung und die aktuelle Spannung wird angezeigt.**

Nach dem Loslassen der Taste wird die kleinste gemessene Spannung angezeigt, sofern der Test ausreichend lange für eine stabile Testspannung lief.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

Der Boost-Konverter kann auch über einen festen I/O-Pin geschaltet werden, um die Batterielaufzeit zu erhöhen (ZENER_SWITCHED).

Wenn Dein Tester nur den 10:1 Spannungsteiler ohne Boost-Konverter zum Messen einer externen Spannung hat, oder der Boost-Konverter ständig läuft, kannst Du den alternativen Modus (ZENER_UNSWITCHED) aktivieren, welcher die Spannung periodisch ohne Drücken der Test-Taste misst. Zeigt der Tester zwischen den Messungen unten rechts einen Cursor an, kannst Du den Zenertest über zweimaliges Drücken der Test-Taste beenden.

Als weitere Option kannst Du den Zenertest auch während der normalen Bauteilesuche automatisch laufen lassen (HW_PROBE_ZENER). Wird kein Bauteil an den normalen Testpins gefunden, prüft der Tester die Spannung an den Zener-Testpins.

Diese Option steht nur zu Verfügung, sofern entweder ZENER_UNSWITCHED oder ZENER_SWITCHED aktiviert ist.

Für den Fall, dass Dein Tester einen Nicht-Standard-Spannungsteiler hat (nicht 10:1), aktiviere ZENER_DIVIDER_CUSTOM und setze die Widerstandswerte (ZENER_R1 und ZENER_R2).

Beschaltung für Zenerdiode:

- Pin +: Kathode
- Pin -: Anode

5.1.6. Logiktester (Hardware-Option) prüft den Zustand von Logiksignalen mittels einem festen ADC- Pin plus Spannungsteiler. Der Spannungsteiler sollte 4:1 sein, damit Spannungen bis 20 V möglich sind (15 V CMOS). Der ADC-Pin ist TP_LOGIC (in config_<MCU>.h) und der Spannungsteiler wird in config.h gesetzt (LOGIC_PROBE_R1 und LOGIC_PROBE_R2). Es dürfte keine schlechte Idee sei, den Eingangsschutz zu verbessern, z.B. mit einem Paar Schottkypoden.

Nach dem Starten liest der Tester automatisch die Spannung, vergleicht die Spannung mit den Logikpegel-Schwellwerten und zeigt dann den Logikzustand plus die Spannung an:

- | | |
|-------|-----------------|
| 0 für | Low |
| 1 für | High |
| Z für | undefiniert/HiZ |

Falls ein Summer/Pieper vorhanden ist, gibt es noch ein akustisches Signal:

- | | |
|---------------|--|
| - Low | aktiver Summer: kurzer Piep
passiver Summer: kurzer Piep mit niedriger Frequenz |
| - High | aktiver Summer: langer Piep
passiver Summer: kurzer Piep mit hoher Frequenz |
| - undefiniert | Ruhe / kein Piep |

Zum Setzen der Logikfamilie bzw. Vcc/Vdd und den Logikpegel-Schwellwerten gibt es ein einfaches Menü. Mit der Testtaste wählst Du die gewünschte Einstellung aus (markiert mit einem Sternchen). Dann benutze den Drehencoder zum Ändern der Einstellung. Beim Ändern der Logikfamilie bzw. von Vcc/Vdd werden die Schwellwerte automatisch angepasst. Danach kannst Du die Schwellwerte bei Bedarf ändern. Im Fall einer unüblichen Vcc/Vdd-Spannung bitte die nächst höhere auswählen und dann die Schwellwerte entsprechend ändern. Die Standardwerte für Vcc/Vdd sind:

- TTL : 5 V
- CMOS : 3.3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V

Und wie gewohnt, zwei kurze Tastendrücke beenden den Logiktester.

5.1.7. Durchgangsprüfer (Hardware-Option) Diese Funktion prüft Schaltungen auf Durchgang und gibt Dir ein akustisches Signal über einen Summer/Pieper, während auch die Spannung zwischen den Testpins ausgegeben wird. Der Teststrom wird über R1 (680Ω) auf etwa 7 mA begrenzt. Die Schwellwerte für den Summer sind:

Spannung:	aktiver Summer:	passiver Summer:
< 100 mV	kontinuierlicher Ton	wiederholender Piep mit hoher Frequenz
100-700 mV	wiederholender kurzer Ton	wiederholender Piep mit niedriger Frequenz
> 700 mV	kein Ton	

Der kurze Ton zeigt einen möglichen Halbleiterübergang an. Bei einer Unterbrechung oder einem sehr hohen Widerstand liegt die Spannung nahe 5 V.

Nach dem Starten vom Durchgangsprüfer zeigt der Tester die Beschaltung der Testpins für ein paar Sekunden an (kann mit Testtaste übersprungen werden).

Und zwei kurze Tastendrücke beenden den Test.

Beschaltung der Testpins:

- Pin #1: Vcc (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)
- Pin #3: Masse

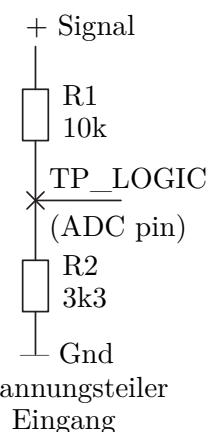


Abbildung 5.1

5.1.8. ESR-Tool Das ESR-Tool kann den Kondensator in der Schaltung messen und zeigt neben der Kapazität den ESR an, wenn ein Kondensator tatsächlich entdeckt wird.

Stelle sicher, dass der Kondenstor **vor dem Anschließen** entladen wurde!

Die gemessenen Werte können von einer Messung außerhalb der Schaltung wegen parallel geschalteter Bauteile abweichen.

Um die Messung zu starten, kurz die Test-Taste drücken.

Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

Beschaltung für Kondensator:

Pin #1: Plus

Pin #3: Minus

5.1.9. Kondensatorleckstrom Der Test auf Leckstrom lädt einen Kondensator auf und zeigt dabei den Strom und die Spannung über den Messwiderstand an. Das Laden beginnt mit $R_l = 680 \Omega$ und schaltet auf $R_h = 470 k\Omega$ um, sobald der Strom einen bestimmten Grenzwert unterschreitet. Wenn die Spannung ihr Minimum erreicht hat und sich nicht weiter ändert, ist der angezeigte Strom der Leckstrom.

Jeder Testzyklus beginnt mit der Anzeige der Belegung der Testpins.

Nach dem Verbinden des Kondensators startet ein Druck der Testtaste das Laden (oder Rechtsdrehung bei einem Drehencoder).

Ein weiterer Druck beendet das Laden, und der Tester entlädt den Kondensator während die Restspannung angezeigt wird.

Sobald der Entladegrenzwert erreicht ist, startet der Tester einen neuen Testzyklus.

Zum Verlassen des Tests zweimal kurz die Testtaste drücken.

Hinweis: **Auf Polarität von Elkos achten!**

Beschaltung für Kondensator:

Pin #1: Plus

Pin #3: Minus

5.1.10. R/C/L-Monitore Die Monitorfunktionen messen ständig passive Bauteile an den Testpins #1 und #3. Nach dem Starten zeigt der Tester die Beschaltung der Testpins für ein paar Sekunden an, was durch die Testtaste übersprungen werden kann.

Zwischen den Messungen gibt es jeweils eine kurze Pause von einer oder zwei Sekunden, die durch einen Cursor unten rechts signalisiert wird. Während der Pause lässt sich der Monitor durch zwei kurze Tastendrücke (Testtaste) beenden.

Verfügbare Monitore:

- R-Monitor (Widerstand)
- C-Monitor (Kapazität plus optional ESR)
- L-Monitor (Induktivität)
- R/C/L-Monitor (R plus optional L, oder C plus optional ESR)
- R/L-Monitor (Widerstand plus optional Induktivität)

Für die C und L-Monitore gibt es Optionen zum Halten des letzten gültigen Messwerts (SW_MONITOR_HOLD_ESR, SW_MONITOR_HOLD_L).

Der letzte Wert wird in der dritten Textzeile angezeigt.

Hinweis:

- *Die Kapazitätswerte für Elkos können etwas niedriger sein als in der normalen Bauteilesuche (verursacht durch die wiederholten Messungen mit einem Gleichstromsignal).*

5.1.11. L/C-Meter (Hardware-Option) Das L/C-Meter basiert auf einer einfachen LC-Oszillatorschaltung, welche von mehreren preiswerten PIC-L/C-Metern benutzt wird. Das übliche Design ($82 \mu\text{H}$ und 1nF) hat eine Grundfrequenz von etwa 595 kHz, und das verbinden eines zusätzlichen Kondensators oder einer Induktivität verringert diese Frequenz.

Mit der Hilfe von einen Referenzkondensator mit bekanntem Wert, den gemessenen Frequenzen und etwas Mathematik kann der Wert des unbekannten Kondensators bzw. Induktivität berechnet werden.

Die PIC-L/C-Meter haben in der Regel einen Messbereich von 10nH bis 100mH , und 0.1pF bis 900nF . Sie scheinen eine Torzeit von 100 ms für den Frequenz- zähler zu nutzen. Die

m-Firmware hat dagegen eine automatische Bereichswahl mit Torzeiten von 100 ms und 1000 ms, um die Auflösung für kleine L/C-Werte zu verbessern. Somit starten die Messbereiche bei ca. 1 nH und 10 fF (0.01 pF). Die maximal messbare Induktivität ist grob 150 mH. Bzgl. der Kapazität bin ich bei der Schaltung auf ein Problem mit dem Ausgangssignal ab ca. 33 nF gestoßen. Dort bekommen die Flanken kleine Sporne, wodurch der Frequenzzähler mehr Pulse sieht als wirklich da sind. Ein Benutzer erwähnte, dass es sich um ein bekanntes Problem der LM311-basierten Oszillatorschaltung handelt. Beim Testen mehrerer Modifikationen ergab sich keine nennenswerte Verbesserung. Daher scheint ein weiterer Komparator oder ein Logik-Gatter mit Schmitt-Trigger- Eingang die beste Lösung zu sein, um das Ausgangssignal des Oszillators zu bereinigen. Das CMOS Vierfach-NAND 4093 funktioniert dazu prima. Bei einem sauberen Ausgangssignal liegt das Maximum der Kapazität bei ca. 120 nF (darüber wird der LC-Oszillator instabil). Der Tester begrenzt die Messungen auf einen unteren Wert von 10 kHz, d.h. die theoretischen Maximalwerte sind 250 mH bzw. 3,5 µF, wenn der LC-Oszillator stabil liefe.

Nach dem Starten vom L/C-Meter führt der Tester als Erstes einen Selbst- Abgleich durch, angezeigt durch eine "abgleichen..." Nachricht. Danach kann der Kondensator oder die Spule zum Messen verbunden werden. Ein kurzer Tastendruck schaltet zwischen C und L-Messung um (Standard: C-Messung). Die Frequenz des LC-Oszillators driftet mit der Zeit etwas (bis zu 100 Hz) und benötigt dann einen erneuten Abgleich.

Wenn Du einen größer werdenden Null- Wert oder ein “-“ ohne angeklemmtem Bauteil siehst, bitte den Selbstabgleich über einen langen Tastendruck starten. Falls es ein Problem mit dem Abgleich gibt oder er durch einen Tastendruck abgebrochen wird, verlässt der Tester das L/C-Meter und gibt einen Fehler aus.

Zwei kurze Tastendrücke beenden das L/C-Meter.

Hinweise:

- Der Referenzkondensator sollte ein 1 nF-Folientyp mit kleiner Toleranz sein. Du kannst aber auch einen üblichen Folienkondensator um die 1 nF nehmen, ihn mit einem guten LCR-Meter messen, und LC_METER_C_REF entsprechend ändern.
- Die L und C-Werte vom LC-Oszillator beeinflussen die Basisfrequenz (f_i). Und der Wert vom Referenzkondensator beeinflusst die Frequenz (f_p) im Selbstabgleichmodus. Wenn deren Werte deutlich abweichen, kannst Du die Frequenzgrenzwerte FL_MIN, FL_MAX, FP_MIN und FP_MAX in tools_LC_Meter.c anpassen, um die internen Prüfungen zu bestehen. Sei vorsichtig! Große Abweichungen können zu Problemen bei den internen Berechnungen führen.
- Wenn Dich die Frequenz des LC-Oszillators und ihr Driften interessiert, dann aktiviere LC_METER_SHOW_FREQ.

5.1.12. Frequenzzähler (Hardware-Option)

Den Frequenzzähler gibt es in zwei Versionen.

Der Einfache besteht aus einem passiven Eingang auf den T0-Pin (F-in) der MCU.

Und der Erweiterte hat neben einem Eingangspuffer auch zwei Oszillatoren zum Testen von Quarzen (für niedrige und hohe Frequenzen) und einen zusätzlichen Frequenzvorteiler.

Beide Schaltungen sind in der Dokumentation von Karl-Heinz [?] beschrieben.

5.1.13. Einfacher Zähler

Ist die Zusatzschaltung für den einfachen Frequenzzähler eingebaut, kannst Du damit Frequenzen von ca. 10 Hz bis zu 1/4 der MCU-Taktfrequenz mit einer Auflösung von 1 Hz bei Frequenzen unterhalb von 10 kHz messen.

Die Frequenz wird ständig gemessen und angezeigt, bis Du die Messung durch zwei kurze Tastendrücke beendest. Die automatische Bereichswahl setzt die Torzeit auf Werte zwischen 10 ms und 1000 ms, je nach Frequenz. Der T0-Pin kann parallel zum Ansteuern einer Anzeige verwendet werden.

5.1.14. Erweiterter Zähler

Der erweiterte Frequenzzähler hat einen zusätzlichen Vorteiler, welcher die Messung höherer Frequenzen erlaubt.

Das theoretische Maximum liegt bei 1/4 des MCU-Taktes multipliziert mit dem Vorteiler (16:1 or 32:1). Die Steuer- signale werden in config_<mcu>.h definiert, und bitte nicht vergessen, in config.h den korrekten Vorteiler auszuwählen.

Der Signaleingang (gepufferter Eingang, Quarz-Oszillator für niedrige Frequenzen, Quarz-Oszillator für hohe Frequenzen) wird über die Testtaste oder den Drehencoder geändert.

Zwei kurze Tastendrücke beenden den Frequenzzähler.

5.1.15. Klingeltester (Hardware-Option) (LOPT/FBT-Tester) prüft Spulen und Transformatoren auf einen Kurzschluss. Die Schaltung erzeugt einen Trigger-Puls und der Tester zählt dann einfach die Anzahl der Schwingungen, welche einen Hinweis auf den Q-Wert gibt. Die Schaltung kann über einen festen Pin (RING_TESTER_PIN) oder über die Testpins (RING_TESTER_PROBES) gesteuert werden. In beiden Fällen ist der T0-Pin des ATmega der Zählereingang (zählt bei fallender Flanke). Der T0-Pin kann auch parallel zum Ansteuern einer Anzeige verwendet werden.

Nach dem Starten des Klingeltesters wird die Belegung der Testpins angezeigt, sofern die Steuerung per Testpins aktiviert ist. Danach prüft der Tester automatisch Spulen/Trafos und zeigt die Anzahl der Schwingungen an. Wie üblich, beenden zwei kurze Tastendrücke den Test.

Interpretation der Schwingungsanzahl für die Schaltung mit der Darlington-Stufe, basierend auf dem Ringtester von Bob Parker:

Schwingungen	Q
0	Kurzschluss oder offen
1 - 3	niedriges Q (schlecht)
4 - 5	mittleres Q (unklar)
>= 6	hohes Q (gut)

Neben der oben erwähnten einfachen Schaltung kann du auch komplexere Varianten verwenden, solange diese mit ca. 5 V laufen, wenig Strom brauchen (< 20 mA) und Zählimpulse mit fallender Flanke generieren.

Beschaltung für die Kontrolle per Testpins:

- Pin #1: Vcc (5 V)
- Pin #2: Pulsausgang (mit 680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)
- Pin #3: Masse
- T0: Zählereingang

5.1.16. Ereigniszähler (Hardware-Option) Der Ereigniszähler nutzt den T0-Pin (F-in) als festen Eingang und reagiert auf die steigende Flanke eines Signals. Der T0-Pin kann nicht parallel zum Ansteuern einer Anzeige verwendet werden. Eine einfache Eingangsstufe wird empfohlen.

Der Zähler wird über ein kleines Menü gesteuert, welches auch die Zählerwerte anzeigt. Die Menüpunkte werden über einen kurzen Tastendruck ausgewählt, und die Einstellungen über den Drehencoder oder zusätzliche Tasten geändert.

Der erste Menüpunkt ist der Zählermodus:

- Zählen zähle Zeit und Ereignisse
- Zeit zähle Ereignisse für eine vorgegebene Zeit
- Ereignisse zähle Zeit für eine vorgegebene Anzahl von Ereignissen

Der zweite Menüpunkt „n“ ist die Anzahl der Ereignisse.

Im Zählermodus „Ereignisse“ wird der Stopwert angezeigt, welcher geändert werden kann.

Ein langer Tastendruck stellt den Stopwert auf einen Vorgabewert (100).

In anderen Zählermodi ist dieser Menüpunkt blockiert.

Der nächste Menüpunkt „t“ ist die Zeitperiode in Sekunden (Vorgabewert: 60 s).

Gleiches Spiel, nur für den Zeit-Modus.

Und der letzte Menüpunkt startet oder stoppt den Zähler über einen langen Tastendruck.

Während der Zähler läuft, werden die Anzahl der Ereignisse und die vergangene Zeit jede Sekunde aktualisiert, und nach dem Stoppen die Ergebnisse angezeigt.

Der Grenzwert für die Zeit ist 43200 s (12 h) und für die Ereignisse $4 \cdot 10^9$.

Sobald einer der Grenzwerte überschritten wird, stoppt der Zähler automatisch.

Der Grenz- oder Stopwert für Ereignisse wird alle 200 ms überprüft. Daher ist bei mehr als 5 Ereignissen/s ein Übersteigen des Wertes möglich.

- **Triggerausgang** kannst Du mit (EVENT_COUNTER_TRIGGER_OUT)

optional aktivieren, um ein anderes Gerät über die Testpins zu steuern.

Der Triggerausgang wird während des Zählens auf High gesetzt, was bedeutet:
steigende Flanke beim Start und fallende Flanke bei Stop.

Beschaltung für Triggerausgang über die Testpins:

- Pin #1: Masse
- Pin #2: Ausgang (680Ω Widerstand zur Strombegrenzung)
- Pin #3: Masse

5.1.17. Drehencoder

Diese Funktion testet Drehencoder und bestimmt das Pin-out.

Deine Aufgabe ist es, die Testpins an den Drehencoder (A, B, Common) anzuschließen und den Encoder nach rechts (also Uhrzeigersinn) zu drehen.

Der Algorithmus benötigt 4 Grey-Code-Schritte zur Erkennung.

Die Drehrichtung ist wichtig zur Erkennung von A und B, da eine falsche Richtung zur Ver-drehung der Pins führen würde.

Wenn ein Drehencoder entdeckt wird, gibt der Tester die Pinbelegung aus und wartet auf einen Tastendruck beim Auto-Hold-Modus oder wartet kurz beim kontinuierlichen Modus.

Zum Beenden die Test-Taste kurz während eines Suchlaufs drücken.

5.1.18. Kontrast

Für manche grafische LCD-Module kannst du den Kontrast stellen.

Ein kurzer Tastendruck erhöht den Wert, ein langer verkleinert ihn.

Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

Ist ein Drehencoder vorhanden, kann der Kontrastwert damit ebenfalls geändert werden.

5.1.19. Detektor/Decoder für IR-Fernbedienungen

Diese Funktion erkennt und dekodiert Signale von IR-Fernbedienungen und benötigt ein IR-Empfängermodul, wie z.B. aus der TSOP-Serie.

Beim Übersetzen der Firmware kannst Du zwischen zwei Anschlussvarianten wählen.

Bei der ersten Variante wird das Modul mit den normalen Testpins verbunden (SW_IR_RECEIVER). Die zweite Variante ist ein festes Modul, welches mit einem bestimmten MCU-Pin verbunden ist (HW_IR_RECEIVER).

Wenn ein bekanntes Protokoll erkannt wird, gibt der Tester das Protokoll, Adresse (sofern verfügbar), Kommando und ggf. zusätzliche Informationen hexadezimal aus.

Das Ausgabeformat ist: <Protokoll> <Datenfeld(er)>

Bei einem defekten Datenpaket wird „?“ als Datenfeld ausgegeben.

Ist das Protokoll unbekannt, zeigt der Tester die Anzahl der Pausen & Pulse und die Dauer des ersten Pulses und der ersten Pause in Einheiten von 50 μ s an: ? <Pulse>:<erster Pulse>-<erste Pause>

Wenn die Anzahl der Pulse bei verschiedenen Tasten der Fernbedienung gleich bleibt, ist die Modulation sehr wahrscheinlich PDM oder PWM.

Eine sich ändernde Anzahl von Pulsen weist auf Bi-Phase-Modulation hin.

Zum Beenden die Test-Taste einmal kurz drücken.

Unterstützte Protokolle und ihre Datenfelder:

- JVC <Adresse>:<Kommando>
 - Kaseikyo (aka Japancode, 48 Bit) <Herstellercode>:<System>-<Produkt>:<Funktion>
 - Matsushita (Panasonic MN6014, C6D6 / 12 bits) <Gerätecode>:<Datencode>
 - Motorola <Kommando>
 - NEC (Standard & Erweitert) <Adresse>:<Kommando> R für Wiederholsequenz
 - Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresse>:<Kommando>
 - RC-5 (Standard) <Adresse>:<Kommando>
 - RC-6 (Standard) <Adresse>:<Kommando>
 - Samsung / Toshiba (32 Bit) <Gerätecode>:<Datencode>
 - Sharp <Adresse>:<Kommando>
 - Sony SIRC (12, 15 & 20 Bit) 12 & 15: <Kommando>:<Adresse> 20: <Kommando>:<Adresse>:<Erweitert>
- Optionale Protokolle (SW_IR_RX_EXTRA):
- IR60 (SDA2008/MC14497) <Kommando>

- Matsushita (Panasonic MN6014, C5D6 / 11 bits) <Gerätecode>:<Datencode>
- NEC µPD1986C <Datencode>
- RECS80 (Standard & Erweitert) <Adresse>:<Kommando>
- RCA <Adresse>:<Kommando>
- Sanyo (LC7461) <Gerätecode>:<Taste>
- Thomson <Gerät>:<Funktion>

Die Trägerfrequenz vom TSOP IR-Empfängermodul muss nicht genau zur Fernsteuerung passen.

Es verringert sich eigentlich nur die Reichweite, was für unseren Zweck aber kein Problem darstellt.

Ist die Summer/Pieper-Option vorhanden, kannst Du einen kurzen Bestätigungston für gültige Daten-Pakete aktivieren (SW_IR_RX_BEEP).

- IR-Empfängermodul an Testpins bitte erst im IR-Fernbedienungsdetektor anschließen!

Beschaltung für das TSOP-Modul (Standard-Pinout SW_IR_RX_PINOUT_G_V_D):

Pin #1:	Masse/Gnd
Pin #2:	Vs (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)
Pin #3:	Data/Out

Die Firmware kann auch auf ein alternatives Pinout umgestellt werden, sofern es notwendig sein sollte. Dies ist insbesondere für Tester mit Nullkraftsockel nützlich:

- alternative Beschaltung SW_IR_RX_PINOUT_D_G_V

Pin #1:	Data/Out
Pin #2:	Gnd
Pin #3:	Vs (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

- alternative Beschaltung SW_IR_RX_PINOUT_D_V_G

Pin #1:	Data/Out
Pin #2:	Vs (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)
Pin #3:	Gnd

Hinweis: Der Widerstand zur Strombegrenzung setzt ein IR-Empfängermodul mit einem Versorgungsspannungsbereich von ca. 2,5 - 5 V voraus.

Wenn Du ein 5 V-Modul hast, kannst Du in config.h den Widerstand auf eigene Gefahr abschalten. Ein Kurzschluss kann allerdings die MCU zerstören.

- Für das feste IR-modul bitte Port und Daten-Pin in config_<MCU>.h passend setzen.

5.1.20. IR-Fernbedienung Die IR-Fernbedienung sendet Fernbedienungscodes, welche Du zuvor eingegeben hast, und dient zum Testen von IR-Empfängern bzw. von Geräten mit IR-Fernbedienung.

Diese Funktion benötigt eine zusätzliche Eingabeoption, wie z.B. ein Drehencoder, ein Display mit mehr als vier Textzeilen und eine einfache Treiberschaltung für die IR-LED.

Der Tester zeigt Dir das Protokoll, die Trägerfrequenz, das Tastverhältnis des Trägers und ein paar Datenfelder.

Mit einem kurzen Druck der Test-Taste schaltest Du zwischen den Punkten hin und her.

Der ausgewählte Punkt wird durch ein „*“ gekennzeichnet.

Über den Drehencoder (oder andere Eingabeoption) änderst Du die Einstellung bzw. den Wert eines Punktes.

Bei einem langen Druck der Test-Taste sendet der Tester den IR-Code solange die Test-Taste gedrückt bleibt. Und wie üblich beenden zwei kurze Tastendrücke die Funktion.

Wenn Du das Protokoll änderst, werden Trägerfrequenz und Tastverhältnis auf die Standardwerte des jeweiligen Protokolls gesetzt.

Du kannst diese aber nach Belieben ändern.

Die Trägerfrequenz kann auf 30 bis 56 kHz gestellt werden, und das Tastverhältnis auf 1/2 (50 %), 1/3 (33 %) oder 1/4 (25 %).

Die Datenfelder sind die Teile des Fernbedienungscodes, die Du setzen kannst.

Sie werden weiter unten erklärt und sind meistens nur die Adresse und das Kommando.

Unterstützte Protokolle und ihre Datenfelder:

- JVC <Adresse:8> <Kommando:8>
- Kaseikyo (Japanese Code) <Hersteller:16> <System:4> <Produkt:8> <Funktion:8>

- Matsushita (Panasonic, MN6014 12 bits) <Gerät:6> <Taste:6>
 - Motorola <Kommando:9>
 - NEC Standard <Adresse:8> <Kommando:8>
 - NEC Extended <Adresse:16> <Kommando:8>
 - Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresse:8> <Kommando:8>
 - RC-5 Standard <Adresse:5> <Kommando:6>
 - RC-6 Standard, Mode 0 <Adresse:8> <Kommando:8>
 - Samsung / Toshiba (32 bits) <Gerät:8> <Taste:8>
 - Sharp / Denon <Adresse:5> <Kommando:8> <Maskierung:1>
 - Sony SIRC-12 <Kommando:7> <Adresse:5>
 - Sony SIRC-15 <Kommando:7> <Adresse:8>
 - Sony SIRC-20 <Kommando:7> <Adresse:5> <Erweitert:8>
- Optionale Protokolle (SW_IR_RX_EXTRA):
- Thomson <Gerät:4> <Funktion:7>

Die Datenfelder sind durch Leerzeichen getrennt und ihre Syntax ist:

<Feldname>:<Anzahl Bits>

Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

- Pin #2: Ausgang (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)
 Pin #1 und #3: Masse

Hinweis: Der Signalausgang (Test-Pin #2) hat einen Widerstand zur Strombegrenzung und kann eine IR-LED mit nur etwa 5 mA direkt schalten, was für eine typische IR-LED mit einem If von 100 mA **nicht** ausreichend ist. Daher wird ein einfacher Treiber auf Basis eines Transistors, der IR-LED und einem Widerstand zur Strombegrenzung benötigt.

Die Abbildung ?? zeigt einen Treiber, welcher die IR-LED (Vf 1.5 V, If 100 mA) mit 50 mA schaltet.

Hinweis:

Falls das Timing der Pulse/Pausen nicht passen sollte, bitte die alternative Warteschleifenmethode SW_IR_TX_ALTDELAY auf Seite ?? aktivieren. Dies ist notwendig, wenn der C-Compiler die Standardwarteschleife trotz Anweisung, den Inline-Assembler-Code beizubehalten, optimiert.

5.1.21. Opto-Koppler-Test Dieser Test prüft Opto-Koppler und gibt V_f der LED, den CTR-Wert (auch If) und t_{on} bzw. t_{off} Zeiten (für Transistor Typen) aus.

Unterstützt werden Standard-NPN-Transistoren, NPN-Darlington-Stufen und TRIACs. Für die CTR-Messung wird der I/O-Pin der MCU kurzzeitig für ca. 3 ms überlastet. Das Datenblatt gibt einen maximalen Ausgangsstrom vom 20 mA an, wir überlasten den Pin aber bis zu ca. 100 mA.

Daher ist der maximale CTR-Wert begrenzt, und Werte über 2000 % sollte man mit Vorsicht genießen. Der maximale Strom für die LED ist 5 mA, was bei TRIAC-Typen zu beachten ist.

Relais-Typen (MOSFET back to back) werden als Transistor erkannt und der CTR-Wert ist dann bedeutungslos. Typen mit anti-parallelen LEDs werden ignoriert.

Zum Testen brauchst Du einen einfachen Adapter mit folgenden drei Testpunkten:
 Transistor-Typ:

- Anode der LED
- Kathode der LED und Emitter vom Transistor miteinander verbunden
- Kollektor vom Transistor

TRIAC-Typ:

- Anode der LED

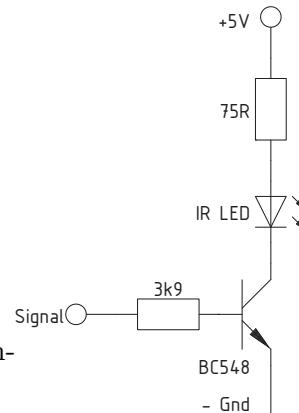


Abbildung 5.2.
IR-Treiber

- Kathode der LED und MT1 vom TRIAC miteinander verbunden
- MT1 vom TRIAC

Du kannst den Adapter nach Belieben mit den drei Testpins vom Tester verbinden. Der Tester findet die Anschlussbelegung dann automatisch. Nach dem Starten bitte den Adapter mit den Testpins vom Tester verbinden und kurz die Taste zum Prüfen drücken. Wenn ein Opto-Koppler gefunden wurde, zeigt der Tester den Typen und verschiedene Infos an.

Wurde keiner erkannt, erfolgt die Anzeige von „keiner“.

Ein blinkender Cursor weist darauf hin, dass ein Tastendruck für die nächste Prüfung erwartet wird. Zwei kurze Tastendrücke beenden, wie üblich, den Test.

5.1.22. Fotodioden-Test Mit dieser Testfunktion kannst Du den Strom einer Photodiode beobachten. Als erstes wird für ein paar Sekunden die Testpinbelegung angezeigt, welche mit einem Tastendruck vorzeitig beendet werden kann. Dann springt der Tester zum Beobachten des Stroms I_P mit der Diode im Sperrrichtungsbetrieb, gekennzeichnet durch „rev“. Ein kurzer Tastendruck schaltet den Betriebsmodus auf Vorwärtsrichtung (Photoelement) um, gekennzeichnet durch „no“. Ein weiterer Tastendruck schaltet den Modus wieder zurück. Und wie Du bereits ahnst, zwei kurze Tastendrücke beenden die Testfunktion.

Zum Testen der Photodiode diese z.B. temporär mit der Hand abdunkeln oder mit einer geeigneten Lichtquelle aus unterschiedlichen Entfernung bestrahlen. Weniger Licht resultiert in weniger Strom, und umgekehrt. Evtl. fängt der Tester etwas EM-Störungen auf, die zu einem kleinen Strom führen können, speziell im Sperrrichtungsbetrieb. Das sieht man sehr gut, wenn gar keine Photodiode angeklemmt ist. Es sei auch darauf hingewiesen, dass Photodioden im Sperrrichtungsbetrieb einen Dunkelstrom haben.

Warnung: Keine Solarzellen testen!

Beschaltung von Test-Pins:

- Pin #1: Anode
- Pin #3: Kathode

5.1.23. Dioden/LED-Schnelltest Der Schnelltest schaut ständig nach einer Diode oder LED an den Testpins #1 und #3. Er ist dazu gedacht, Dioden/LEDs schnell zu prüfen und deren Polarität festzustellen. LEDs blinken während dem Testen.

Nach dem Starten zeigt der Tester die Beschaltung der Testpins für ein paar Sekunden an, was durch die Testtaste übersprungen werden kann. Wenn eine Diode oder LED gefunden wurde, wird deren Pinbelegung und V_f angezeigt. Die Anode ist immer auf der linken Seite, und die Kathode auf der rechten. Im Falle von zwei anti-parallelen Dioden/LEDs wird auch die zweite gezeigt. Du kennst schon die Übung: zum Beenden zweimal kurz die Testtaste drücken.

5.1.24. Modellbau-Servo-Test Diese Funktion erzeugt ein PWM-Signal für Modellbau-Servos, welche mit einem 1 - 2 ms PWM-Puls gesteuert werden.

Die typischen PWM-Frequenzen von 50, 125, 250 und 333 Hz werden unterstützt, und die Pulslänge ist im Bereich von 0,5 bis 2,5 ms einstellbar.

Zusätzlich gibt es einen Sweep-Modus für Pulse von 1 - 2 ms und wählbarer Geschwindigkeit. Die Puls-breite stellst Du mit dem Drehencoder ein. Links für kürzere Pulse, und rechts für längere.

Mit einem langen Tastendruck wird die Pulswidte auf 1,5 ms zurück gesetzt (mittlere Position vom Servo).

Mit einem kurzen Tastendruck wechselst Du zwischen Puls- und Frequenzauswahl (durch ein Sternchen markiert).

In der Frequenzauswahl schaltest Du mit dem Drehencoder zwischen den Frequenzen um. Mit einem langen Tastendruck wird der Sweep-Modus ein- bzw. ausgeschaltet (durch ein „<->“ markiert).

Solange der Sweep-Modus eingeschaltet ist, wird die Pulslänge durch die Sweep-Zeit ersetzt, welche mittels dem Drehencoder geändert werden kann.

Wie üblich beenden zwei kurze Tastendrücke die Funktion.

Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

Pin #2: PWM-Ausgang (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Pin #1 und #3: Masse

Hinweis: Für den Servo benötigst Du eine zusätzliche Stromversorgung.

Hersteller	Pin 1	Pin 2	Pin3
Airtronics	PWM weiss/schwarz	Gnd schwarz	Vcc rot
Futaba	PWM weiss	Vcc rot	Gnd schwarz
hitec	PWM gelb	Vcc rot	Gnd schwarz
JR Radios	PWM orange	Vcc rot	Gnd braun

Tabelle 5.1. Pinbelegungen für typische 3-Pin-Servo-Stecker

5.1.25. OneWire-Scan Der OneWire-Scan zeigt die ROM-Codes all angeschlossenen Busteilnehmer an. Zum Einrichten des OneWire-Busses siehe bitte den Abschnitt „Busse & Schnittstellen“ auf Seite ???. Bei Benutzung der Test-Pins informiert der Tester über die Beschaltung und wartet bis ein externer Pull-Up-Widerstand erkannt wurde.

Mit einem Tastendruck lässt sich dies überspringen.

Bei jedem Tastendruck sucht der Tester nach dem nächsten Busteilnehmer und gibt dessen ROM-Code aus (in hexadezimal). Der erste Teil der Ausgabe ist der Familiencode und der zweite die Seriennummer. Der CRC-Wert wird weggelassen. Bei einem Familiencode $\geq 0x80$ (Bit 7 gesetzt) handelt es sich um einen kundenspezifischen Code, und die oberen (linken) drei Stellen der Seriennummer sind die Kunden-ID.

Der Tester informiert Dich, wenn er den letzten Busteilnehmer gefunden hat, bzw. bei CRC- oder Busfehlern. Im Fall des letzten Busteilnehmers oder eines Busfehlers kannst Du per Tastendruck einen komplett neuen Scandurchlauf starten. Beschaltung von Test-Pins:

Probe #1: Gnd

Probe #2: DQ (Daten)

Probe #3: Vcc (Strom durch 680 Ω Widerstand begrenzt)

Ein externer Pull-Up-Widerstand von 4,7 k Ω zwischen DQ und Vcc wird benötigt!

Wie üblich beenden zwei kurze Tastendrücke die Funktion.

5.1.26. DS18B20/DS18S20 OneWire Temperatursensoren werden ausgelesen.

Zum Einrichten des OneWire-Busses Seite ?? siehe bitte den Abschnitt „Busse“. Bei Benutzung der Test-Pins informiert der Tester über die Beschaltung und wartet dann bis ein externer Pull-Up-Widerstand erkannt wurde. Mit einem Tastendruck lässt sich dies überspringen.

Nach den Verbinden des DS18B20/DS18S20 als einziger Client am Bus startet ein Tastendruck das Auslesen der Temperatur (kann fast eine Sekunde dauern). Zum Beenden zweimal kurz die Test-Taste drücken. Mit einem langen Tastendruck wählst Du den Auto-Modus (automatische Aktualisierung), welcher durch ein „*“ in der ersten Zeile signalisiert wird.

Ein weiterer langer Tastendruck schaltet wieder zurück zum manuellen Modus.

Beschaltung für das DS18B20 Sensor:

Probe #1: Masse/Gnd

Probe #2: DQ (Daten)

Probe #3: VSS (680 Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Hinweis: Ein externer Pull-Up-Widerstand von 4,7 k Ω zwischen #2 DQ und #3 Vcc nötigt!

Tips: - Option für DS18B20: Runden auf 0,1 °C/F (UI_ROUND_DS18B20)

- Option für DS18S20: hohe Auflösung (DS18S20_HIGHRES)

- Die DS18B20-Funktion kann auch den Sensor DS1822 lesen.

Zum Beenden zweimal kurz die Test-Taste drücken.

5.1.27. DHTxx-Temperatur & Luftfeuchte-Sensoren zum Lesen von DHT11, DHT22 und kompatiblen Temperatur & Luftfeuchte-Sensoren.

Zuerst zeigt der Tester die Beschaltung der Test-Pins und wartet auf den externen Pull-Up-Widerstand.

Danach wird der ausgewählte Sensortyp angezeigt (Standard: DHT11), welcher durch einen kurzen Druck der Testtaste gelesen wird.

Bei erfolgreichem Lesen gibt der Tester die Messwerte aus, bei einem Fehler nur ein „.

Ein langer Tastendruck ändert den Sensortypen, und zwei kurze Tastendrücke beenden die Funktion. Beim Ändern des Sensortyps hast Du die Möglichkeit, den automatischen Lesemodus (jede Sekunde) zu aktivieren. Dieser wird durch ein "*" nach dem Sensornamen signalisiert.

Unterstützte Sensoren:

- DHT11: DHT11, RHT01
- DHT22: DHT22, RHT03, AM2302
- DHT21, RHT02, AM2301, HM2301
- DHT33, RHT04, AM2303
- DHT44, RHT05

Beschaltung von Test-Pins:

- Probe #1: Gnd
- Probe #2: Data
- Probe #3: Vdd (Strom nicht begrenzt)

Ein externer Pull-Up-Widerstand von 4,7 kΩ zwischen Data und Vdd wird benötigt! Manche Sensormodule haben bereits einen 10 kΩ Pull-Up-Widerstand integriert, welcher ebenfalls gut mit kürzeren Kabeln funktioniert.

Hinweis: Wegen des Strombedarfs des Sensor kann der 680 Ω Testwiderstand nicht zur Strombegrenzung genutzt werden.

Also Vorsicht, ein Kurzschluss kann die MCU beschädigen.

5.1.28. MAX6675/MAX31855 Thermoelement-Konverter

Die beiden MAX sind Thermoelement-Konverter mit Kaltstellenkompensation und werden über den SPI-Bus gesteuert. Der MAX6675 ist nur für Thermoelemente vom Typ K, während es den MAX31855 für mehrere Typen gibt. Der MAX31855 hat eine Betriebsspannung von 3.3 V und benötigt daher Pegelwandler.

Die Bedienung für beide MAX ist gleich. Durch das Drücken der Testtaste wird eine Messung ausgelöst und die Temperatur angezeigt. Bei Fehlern kommt ein “-“ stattdessen. Für den automatischen Lesemodus (jede Sekunde) die Testtaste lange drücken (wird durch ein “**“ nach dem MAX-Namen signalisiert). Ein zweiter langer Tastendruck beendet wieder den automatischen Lesemodus. Und zwei kurze Tastendrücke beenden die Funktion.

Hinweise:

- Passe MAX31855_CS in config_<MCU>.h an!
- Auch benötigst Du die SPI-Lesefunktion (SPI_RW).

5.1.29. BH1750 Umgebungslichtsensor ist ein günstiger Umgebungslichtsensor mit I2C-Bus und 3,3 V Betriebsspannung. Mit einem 3,3 V Spannungsregler und Pull-Up-Widerständen für SCL und SDA (auf 3,3 V) kann er meistens direkt an einem 5 V ATmega betrieben werden, sofern keine anderen I2C-ICs am Bus Probleme machen. Ansonsten sind Pegelwandler nötig.

Zum Messen einmal kurz die Testtaste drücken. Alternativ kann mit einem langen Tastendruck in den automatischen Modus gewechselt werden (ein “**“ erscheint in der Titelzeile); und auch wieder zurück. Im automatischen Modus wird jede Sekunde gemessen. Bei einem Fehler zeigt der Tester ein “-“ statt der Lichtstärke. Und wie üblich, zwei kurze Tastendrücke beenden die Funktion.

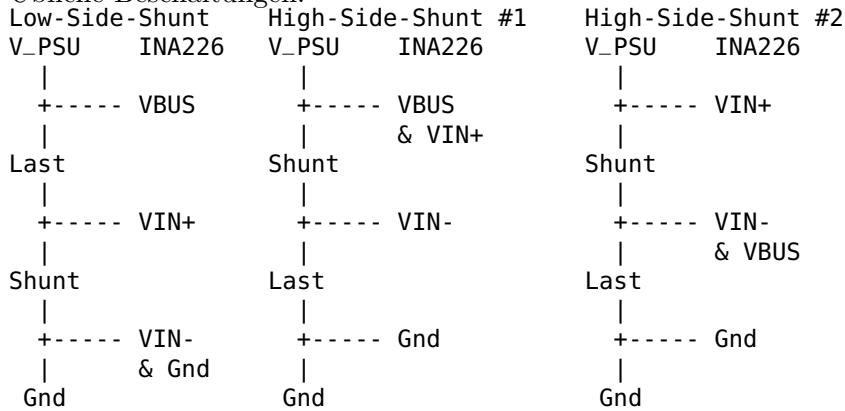
Hinweise:

- BH1750-Module haben meistens einen 3,3 V LDO und 4,7 kΩ Pull-Up-Widerstände (auf 3,3 V) für SCL und SDA.
- Ein “Error“ direkt nach dem Funktionsaufruf deutet auf ein Sensorproblem hin, z.B. keine I2C-Kommunikation.

5.1.30. INA226 Leistungsmonitor mit I2C-Schnittstelle, wird üblicherweise mit 3,3 V oder 5 V betrieben. Er misst die Spannung der Last (VBUS, bezogen auf Gnd) und die Spannung über einen Strommesswiderstand (Shunt, VIN+ und VIN-). Wenn Du den INA226 mit 3,3 V betreibst und Pull-Up-Widerstände für SCL und SDA auf 3,3 V hast, sollte er mit dem 5 V-ATmega funktionieren, sofern der I2C-Bus nicht mit anderen 5V-ICs geteilt wird. Ansonsten sind Pegelwandler nötig.

Zum Messen einmal kurz die Testtaste drücken. Alternativ kann mit einem langen Tastendruck in den automatischen Modus gewechselt werden (ein “*“ erscheint in der Titelzeile); und auch wieder zurück. Im automatischen Modus wird jede Sekunde gemessen. Bei einem Fehler zeigt der Tester ein “-“ statt der Messwerte. Und wie üblich, zwei kurze Tastendrücke beenden die Funktion.

Übliche Beschaltungen:



Für die Beschaltungen Low-Side-Shunt und High-Side-Shunt #1 hat die Spannung über den Strom-Shunt Einfluss auf VBUS, weswegen INA226_MINUS_SHUNT zur Kompensation aktiviert werden sollte. Bei High-Side-Shunt #2 spielt die Shunt- Spannung keine Rolle bei der Messung. Wegen der hohen Auflösung der Shuntdifferenzmessung von 2,5 µV hat die Verkabelung und Umgebung (EMV) einen großen Einfluss beim Messen kleiner Ströme um 0 A, welcher zu deutlich variierenden Stromwerten führt. Zur Linderung dieses Verhaltens kannst Du einen Nullgrenzwert aktivieren und einstellen (INA226_SHUNT_ZERO_THRESHOLD), d.h. alle Werte kleiner gleich dem Grenzwert werden als Null angesehen. Der Nullgrenzwert wird als ADC-Rohwert der Spannung am Strom-Shunt gesetzt und umfasst auch den negativen Bereich (1: +/- 2,5 µV, 2: +/- 5 µV, 3: +/- 7,5 µV, ...).

Ein weiteres Merkmal vom INA226 ist eine integrierte Durchschnittswertbildung, die konfiguriert werden kann (INA226_SAMPLES). Dabei wird aus einer vor- gegebenen Anzahl von Messungen ein Durchschnittswert gebildet. Die Anzahl darf 1 (kein Durchschnitt), 4, 16, 64, 128, 512 oder 1024 betragen.

Falls Du die Summer-Option hast, kannst Du einen Leistungsalarm aktivieren (INA226_POWER_ALARM), der bei Überschreiten eines bestimmten Schwellwerts den Summer kurz piepen lässt. Der Schwellwert wird in mW gesetzt.

Hinweise:

- Ein “Error“ direkt nach dem Start deutet auf ein Sensorproblem hin, z.B. keine I2C-Kommunikation.
- Das Maximum für V_{PSU} ist 36 V.

5.1.31. Licht

Dies ist ein allgemeiner Schaltausgang zum Steuern von einem zusätzlichen Schaltungsteil, wie z.B. einem LED-Licht. Der Tester schaltet einfach den Ausgang zwischen Low und High um, jedes Mal bei Aufruf. Lasten kleiner 20mA können direkt betrieben werden.

5.1.32. Voltmeter 0-5 V DC

Ein einfaches Voltmeter für Gleichspannungen von 0 bis 5 V mit zwei auswählbaren Eingangsimpedanzen (hoch: 470 kΩ, niedrig: 700 Ω).

Nach der Anzeige der obligatorischen Test-Pin-Beschaltung, die mit einem Tastendruck übersprungen werden kann, startet die Messung im Modus mit hoher Eingangsimpedanz (gekennzeichnet durch ein “H“ in der ersten Zeile).

Mit einem kurzen Tastendruck wechselst Du zur niedrigen Eingangsimpedanz (gekennzeichnet durch ein “L“), und auch wieder zurück.

Zusätzliche Funktionalität erhält man, wenn ein Summer/Pieper installiert ist. Sobald ein bestimmter Schwellwert überschritten wird, erzeugt der Tester einen kurzen Piepton. Ein kurzer Tastendruck schaltet diese Funktion ein, was durch Ausgabe des Schwellwertes in Klammern in der zweiten Zeile (nach dem Messwert) bestätigt wird. Ist zudem auch ein Drehencoder (oder eine andere Eingabeoption) vorhanden, kann der Schwellwert in 0,1 V-Schritten geändert werden (links: niedriger, rechts: höher).

Und zu guter Letzt, zwei kurze Tastendrücke beenden das Voltmeter.

Beschaltung von Test-Pins:

Probe #1: positiv

Probe #3: negativ

Warnungen:

- Kein Eingangsschutz! Nur für Gleichspannungen von 0 bis 5 V!
- Kein Verpolschutz! Also besonders vorsichtig sein!

5.1.33. Selbsttest Wenn Du den Selbsttest über das Menü gestartet hast, bittet dich der Tester die drei Testpins kurz zu schließen und wartet solange, bis er dies erkennt.

Bei Problemen kannst Du das Warten mit einem Tastendruck abbrechen.

Der Selbsttest führt jeden Test 5-mal aus.

Mit einem kurzen Tastendruck wird der aktuelle Test übersprungen,
mit einem langen Tastendruck der komplette Test.

In Test #4 ist der Kurzschluss wieder zu entfernen. Der Tester wartet dann so lange.

Die Testschritte sind:

- T1: interne Spannungsreferenz (in mV)
- T2: Vergleich der R_l-Widerstände (Offset in mV)
- T3: Vergleich der R_h-Widerstände (Offset in mV)
- T4: Entfernen des Kurzschlusses der Testpins/kabel
- T5: Leckstromtest für Testpins mit Gnd-Pegel (Spannung in mV)
- T6: Leckstromtest für Testpins mit Vcc-Pegel (Spannung in mV)

Hinweise:

- Den Selbsttest ohne ISCP/ISP-Kabel durchführen!
- Wenn die T2-Werte sich zwischen den Testpin-Paaren mehr als 5 mV unterscheiden, könnte das an zu ungleichen R_l-Testwiderständen liegen.
- Das gleiche gilt für die T3-Werte und R_h-Testwiderstände.
- Lange Testkabel haben einen negativen Einfluss und verschlechtern die Werte in T2, T3, T5 und T6.
- Seltsame Werte sind meistens ein Zeichen für defekte MCU-Pins, Kurzschlüsse, Schmutz oder größere Kontaktprobleme.

5.1.34. Selbstabgleich Der Selbstabgleich misst den Widerstand und die Kapazität der Messkabel, d.h. von Platine, interner Verkabelung und dem Messkabel als Summe, um einen Nulloffset zu bestimmen. Auch wird der interne Widerstand der MCU-Portpins im Pull-Up und Pull-Down Modus bestimmt. Wenn der Abgleich übersprungen wird oder unplausible Werte gemessen werden, werden die Standardwerte der Firmware angenommen.

Wenn alles sauber durch läuft, werden die neuen Werte angezeigt, aber **nicht** automatisch im EEPROM gespeichert (siehe Speichern/Laden). Der Spannungsoffset des Analogkomparators wird automatisch bei der Messung eines Kondensators bestimmt (bei der normalen Bauteilesuche), wenn der Kondensator einen Wert zwischen 100 nF und 3,3 µF hat.

Außerdem wird gleichzeitig der Offset der internen Spannungsreferenz gemessen.

Bevor der Selbstabgleich ausgeführt wird, solltest Du einen Folienkondensator mit einer Kapazität zwischen 100 nF und 3,3 µF min. 3-mal messen, damit die oben erwähnten Offsets bestimmt werden können. Typischerweise liefert die erste Messung einen zu niedrigen Wert, die zweite einen zu hohen und erst die dritte eine korrekten Wert.

Das wird durch die sich selbst abgleichenden Offsets verursacht.

Mit einem festen Kondensator zum Selbstabgleich wird der automatische Abgleich in der Kapazitätsmessung durch eine eigene Funktion ersetzt, welche während des Selbstabgleichs ausgeführt wird. Somit brauchst Du nicht mehr vorher einen Folienkondensator zu messen.

Falls der Kapazitätsoffset zwischen den Test-Pin-Paaren zu sehr variiert, kannst Du in config.h, Abschnitt ?? ab Seite ??, auf spezifische Offsets je Test-Pin-Paar umschalten (CAP_MULTIOFFSET).

Das Gleiche ist für den Widerstandsoffset möglich (R_MULTIOFFSET).

Der Selbstabgleich ist dem Selbsttest vom Ablauf und der Bedienung her sehr ähnlich.

Die Schritte des Selbstabgleichs sind:

- A1: Offsets für interne Spannungsreferenz und Analogkomparator
(nur bei festem Abgleichkondensator)
- A2: Widerstand der Testpins/Kabel (in $10 \text{ m}\Omega$)
- A3: Entfernen des Kurzschlusses der Testpins/Kabel
- A4: interner Widerstand der Portpins für Gnd (Spannung über RiL)
- A5: interner Widerstand der Portpins für Vcc (Spannung über RiH)
- A6: Kapazität der Testpins/Kabel (in pF)

Erlaubte Maximalwerte:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - Widerstand Testpin/Kabel | < $1,50 \Omega$ (zwei in Reihe) |
| - Kapazität Testpin/Kabel | < 100 pF |
| - Interner Widerstand vom IO-Pin im Low-Modus (RiL) | < 25Ω |
| - Interner Widerstand vom IO-Pin im High-Modus (RiH) | < 29Ω |

Hinweise:

- Den Selbstabgleich ohne ISCP/ISP-Kabel durchführen!
- Wenn der Widerstandswerte der Testpins zu sehr variieren, könnte ein Kontaktproblem vorliegen.
- Falls der Kapazitätsoffset (A6) Null ist, dürfte es an einem Entladeproblem liegen, (CAP_DISCHARGED erhöhen).

Merke: Abgleich ist nicht Kalibrierung!

Kalibrierung ist die Prozedur, Messergebnisse mit verfolgbaren Standards zu vergleichen und die Abweichungen zu notieren.

Der Zweck ist die Überwachung der Abweichungen über die Zeit.

Der Abgleich ist die Prozedur, ein Messgerät so einzustellen, dass es seine Vorgaben bzgl. Genauigkeit und anderer Parameter einhält.

5.1.35. Speichern/Laden Nach dem Selbstabgleich kannst Du mit dieser Funktion die im EEPROM gespeicherten Abgleichswerte aktualisieren. Beim nächsten Neustart vom Tester werden dann diese Werte (Profil #1) automatisch geladen und benutzt.

Zur Bequemlichkeit stehen zwei Profile zum Speichern bzw. Laden zu Verfügung, z.B. für zwei unterschiedliche Sätze an Messkabeln. Wenn zwei zu wenig sind, kann ein drittes Profil aktiviert werden (UI_THREE_PROFILES).

Die Idee hinter der manuellen Speichern-Funktion ist, daß man z.B. beim temporären Wechsel der Messkabel nur einen Selbstabgleich macht und nach dem Neustart wieder die Werte für die Haupt-Messkabel hat. Ansonsten müsste man für die alten Kabel wieder einen neuen Selbstabgleich machen.

Als Option kannst Du das Lade-Menü automatisch nach dem Einschalten des Testers anzeigen lassen (UI_CHOOSE_PROFILE).

5.1.36. Werte anzeigen Diese Funktion zeigt die aktuellen Abgleich-werte an. Die Nutzung einer externen 2.5 V Spannungsreferenz wird mit einem "*" nach Vcc signalisiert.

5.1.37. Zeichensatz/Symbole Die beiden Menüpunkte geben den kompletten Zeichensatzes bzw. die Bauteile- symbole zu Testzwecken aus. Zeilen/Blöcke starten mit der Adresse (hexadezimal) des ersten Zeichens/Symbols in jener Zeile/Block. Danach folgen entweder 8 Zeichen oder so viele Symbole wie in den Block passen.

5.1.38. Ausschalten Hiermit kannst Du den Tester abschalten, sofern die Funktion über SW_POWER_OFF auf Seite ?? aktiviert wurde.

5.1.39. Exit Damit kannst Du das Menü verlassen, wenn Du z.B. aus Versehen reingegangen bist.

Wie schon erwähnt, kann die Firmware an verschiedene Tester und verschiedene Konfigurationen konfiguriert werden.

6.1. In der k-Version

konfigurierst du über die Makefile. Da der Entwickler für dieses Tester in einem Ordner Vorkonfiguriert hatte, brauchst du in der Praxis lediglich dein Programmer und Anzeigesprache einstellen. Die Zeile 204 habe ich nur aktiviert, weil der Programmschritt sowieso abläuft. Lediglich die Ausgabe wird unterdrückt:

Software	Originál KHK Version 1.13k
Untenordner Name	mega328_color_kit
Benutzt FLASH	98 %
Benutzt EEPROM	87.8 %
Zeile:	Änderung im Makefile:
70	UI_LANGUAGE = LANG_GERMAN
204	CFLAGS += -DFREQUENCY_50HZ
389	PROGRAMMER=usbasp
390	BitClock=20
391	PORT=usb

Tabelle 6.1. Benutzte k-Software und Modifikation im Makefile

Außerdem wurden mit Erfolg getestet : POLOLU a USBtiny ISP

6.2. In der m-Version

sieht die Situation ganz anders aus. Der Entwickler verlässt sich vollständig auf das technische Wissen seiner Unterstützer und ihr Sinn zum Experimentieren.

Als Hilfe dient die Datei Clones.txt, in der die verschiedenen Klone kurz beschrieben werden. Dieser Tester wird dort beispielsweise unter dem Namen AY AT Clone behandelt. (Wer ahnt es schon?) Dies war einer der Gründe, diesen Leitfaden zu verfassen.

Die Einstellungen sind hier verteilt über die Dateien [Makefile](#), [config.h](#) und [config_328.h](#).

6.3. Makefile

Im Makefile werden Einstellungen durch das Setzen von bestimmten Variablen durchführt. Zum Anpassen einfach den Wert oder die Zeichenkette hinter der Variablen ändern. Für manche Variablen gibt es mehrere Vorschläge, die mittels des #-Symbols auskommentiert sind. Dort bitte die gewünschte Einstellung Einkommentieren (# löschen), und ggf. die Standardeinstellung auskommentieren (# einfügen).

6.3.1. MCU-Typ

25 `MCU = atmega328`

Listing 6.1. Vorgewählt ist atmega328

6.3.2. MCU-Taktfrequenz

31 `FREQ = 8`

Listing 6.2. Vorgewählt ist 8MHz

6.3.3. Oszillator-Typ

37 `OSCILLATOR = Crystal`

Listing 6.3. Vorgewählt ist Crystal

6.3.4. Avrdude MCU-Typ

71 PARTNO = m328p

Listing 6.4. Vorgewählt ist m328p

6.3.5. Avrdude ISP-Programmierer

Bei dem Programmierer sind notwendig:

- Name
- BitClock
- Port

```
75 # Arduino as ISP
76 #PROGRAMMER = stk500v1
77 #PORT = /dev/ttyACM0
78 #OPTIONS = -b 19200
79
80 # Bus Pirate
81 #PROGRAMMER = buspirate
82 #PORT = /dev/bus_pirate
83 #OPTIONS = -B 10.0
84
85 # Diamex ALL-AVR/AVR-Prog
86 PROGRAMMER = avrispmkII
87 PORT = usb
88 OPTIONS = -B 1.0
89
90 # Pololu USB AVR Programmer
91 #PROGRAMMER = stk500v2
92 #PORT = /dev/ttyACM0
93 #OPTIONS = -B 1.0
94
95 # USBasp
96 #PROGRAMMER = usbasp
97 #PORT = usb
98 #OPTIONS = -B 20
99
100 # USBtinyISP
101 #PROGRAMMER = usbtiny
102 #PORT = usb
103 #OPTIONS = -P usb -F -B 10
104
105 # Arduino Uno bootloader via serial/USB
106 #PROGRAMMER = arduino
107 #PORT = /dev/ttyACM0
108 #OPTIONS = -D -b 115200
109
110 # Arduino Mega2560 bootloader via serial/USB
111 #PROGRAMMER = wiring
112 #PORT = /dev/ttyACM0
113 #OPTIONS = -D -b 115200
```

Listing 6.5. Wähle dein Programmer! Hier ist Diamex vorgewählt.

Die Liste der Programmer wurde hier schon editiert und einige bekannte Programmer und erprobte Einstellungen zugefügt.

Falls Dein Programmierer nicht aufgeführt ist, bitte die passenden Werte eintragen.

Weitere Informationen findest Du im im Teil ??,

Avrdude-Handbuch oder der Online-Dokumentation [?].

6.4. config.h

Diese Datei dient zum Einstellen von Bedienung und Funktionen. Da es eine normale C-Header-Datei ist, werden die bekannten Kommentar regeln für C verwendet. Um etwas zu aktivieren, ist das // am Zeilenanfang zu löschen. Zum Deaktivieren wird ein // am Zeilenanfang eingefügt. Manche Einstellungen benötigen einen Zahlenwert, der ggf. anzupassen ist.

6.4.1. Hardware Einstellungen

Für diesen Tester muss eingestellt werden:

39 `#define HW_ENCODER`

Listing 6.6. Coder Einstellung

49 `#define ENCODER_PULSES 4`

Listing 6.7. Anzahl der Grey-Code-Impulse pro Schritt oder Rastung

61 `#define ENCODER_STEPS 20`

Listing 6.8. Anzahl der Rastungen oder Schritte

83 `#define HW_REF25`

Listing 6.9. V-Spannungsreferenz für Vcc-Prüfung

92 `#define UREF_25 2495`

Listing 6.10. Referenzspannung in mV (siehe Datenblatt oder Messe es)

117 `#define HW_ZENER`

Listing 6.11. Spannungsmessung bis 50 V DC / Zenerdioden Test

140 `#define ZENER_UNSWITCHED`

Listing 6.12. Man braucht nicht Taste zu drücken

167 `#define HW_PROBE_ZENER`

168 `#define ZENER_VOLTAGE_MIN 1000 /* min. voltage in mV */`

169 `#define ZENER_VOLTAGE_MAX 30000 /* max. voltage in mV */`

Listing 6.13. Zener-Prüfung und Min. Max. Einstellung

Die Min-/Max-Spannungen sind für die Erkennung einer gültigen Zener-Spannung gedacht.

Die Min.-Spannung sollte höher als das Grundrauschen sein, während die Max.Spannung niedriger sein sollte als die Ausgangsspannung des Hochsetzstellers.

191 `#define HW_FREQ_COUNTER_BASIC`

Listing 6.14. Einfacher Frequenzzähler

207 `///#define FREQ_COUNTER_PRESCALER 16 /* 16:1 */`

Listing 6.15. Deaktivierung Prescaller der nicht da ist

6.4.2. Nun folgt die Qual der Wahl der Unmenge von möglichen Optionen der config.h, wählen zu müssen, weil der Speicher Grenzen setzt.

Glücklicher weise, kann man mehrere Sätze erstellen, um sie, je nach Bedarf, wechseln zu können.

235 `#define HW_EVENT_COUNTER`

Listing 6.16. Aktivierung von Ereigniszähler

245 `#define EVENT_COUNTER_TRIGGER_OUT`

Listing 6.17. Aktivierung von Triggerausgang für Ereigniszählers

258	<code>//#define HW_IR_RECEIVER</code>	Listing 6.18. Deaktivierung IR Empfänger (kein Modul vorhanden)
277	<code>//#define HW_LC_METER</code>	Listing 6.19. Option LC meter
317	<code>//#define HW_LOGIC_PROBE</code>	Listing 6.20. Option Logik Probe
331	<code>//#define HW_BUZZER</code>	Listing 6.21. Option Buzzer
343	<code>//#define HW_MAX6675</code>	Listing 6.22. Option MAX6675
353	<code>//#define HW_MAX31855</code>	Listing 6.23. Option MAX31855
362	<code>//#define HW_FLASHLIGHT</code>	Listing 6.24. Option Taschenlampe
371	<code>//#define HW_BH1750</code>	Listing 6.25. Option BH175VFI
389	<code>//#define HW_INA226</code>	Listing 6.26. Option INA226
6.4.3. Software Einstellungen		
408	<code>#define SW_SELFTEST</code>	Listing 6.27. Option selbsttest
417	<code>//#define SW_PWM_SIMPLE</code>	Listing 6.28. Deaktivierung einfachen PWM
427	<code>#define SW_PWM_PLUS</code>	Listing 6.29. Aktivierung erweiterten PWM
436	<code>#define PWM_SHOW_DURATION</code>	Listing 6.30. zeigt beim PWM auch die Impulsdauer an)
444	<code>#define SW_INDUCTOR</code>	Listing 6.31. Spulen Messen
454	<code>//#define SW_ESR</code>	Listing 6.32. ESR Messen
472	<code>//#define SW_ENCODER</code>	Listing 6.33. Drehgeber Messen
482	<code>#define SW_SQUAREWAVE</code>	Listing 6.34. Rechteck Signal Generator

```

492 // #define SW_IR_RECEIVER
      Listing 6.35. IR Fernbedienung dekoder

501 #define SW_IR_RX_PINOUT_G_V_D /* 1-Gnd 2-Vcc 3-Data (default) */
      Listing 6.36. Pinbelegung von IR Fernbedienung Modulen

514 // #define SW_IR_DISABLE_RESISTOR
      Listing 6.37. Strombegrenzung Widerstand für IR Empfänger Module

523 // #define SW_IR_RX_BEEP
      Listing 6.38. Bestätigungston für gültiges Datenframe/-paket

532 // #define SW_IR_RX_EXTRA
      Listing 6.39. Zusätzliche Protokolle für den IR-Detektor/Dekoder

543 // #define SW_IR_TRANSMITTER
      Listing 6.40. IR-Fernbedienungssender

553 // #define SW_IR_TX_ALTDELAY
      Listing 6.41. Alternative Verzögerungsschleife für IR-Fernbedienungssender

562 // #define SW_IR_TX_EXTRA
      Listing 6.42. Zusätzliche Protokolle für IR-Fernbedienungssender

570 // #define SW_OPTO_COUPLER
      Listing 6.43. Optokoppler Test

578 // #define SW_UJT
      Listing 6.44. Unijunction-Transistoren prüfen

586 // #define SW_SCHOTTKY_BJT
      Listing 6.45. Schottky Transistor (Schottky-geklemmter BJT) prüfen

596 // #define SW_SERVO
      Listing 6.46. Aktivierung von Servos testen

606 #define SW_DS18B20
      Listing 6.47. Aktivierung von Temperatur Messung mit DS18B20

1246 #define UI_ROUND_DS18B20
      Listing 6.48. Erhöhung der Messgenauigkeit auf 0,1°C

617 // #define SW_DS18S20
      Listing 6.49. Aktivierung von Temperatur Messung mit DS18S20 auf 0,01°C

628 // #define ONEWIRE_READ_ROM
      Listing 6.50. OneWire-ROM-Code lesen und anzeigen

638 // #define SW_ONEWIRE_SCAN
      Listing 6.51. OneWire-Scan zeigt die ROM-Codes all angeschlossenen Busteilnehmer an

```

```

647 //##define SW_CAP_LEAKAGE
    
```

Listing 6.52. Kondensatorleckstromtest

```

656 //##define SW_REVERSE_HFE
    
```

Listing 6.53. Anzeige der umgekehrten hFE für BJTs

```

666 //##define SW_HFE_CURRENT
    
```

Listing 6.54. Anzeige I_C/I_E Prüfstrom für hFE-Messung

```

674 //##define SW_C_BE
    
```

Listing 6.55. Anzeige C_be (base-emitter capacitance) für BJTs

```

688 //##define SW_MONITOR_RCL /* R plus L, or C plus ESR */
    
```

Listing 6.56. R/C/L Monitore

```

698 //##define SW_MONITOR_HOLD_ESR /* auto-hold ESR (C monitor) */
699 //##define SW_MONITOR_HOLD_L /* auto-hold L (L monitor) */
    
```

Listing 6.57. C/L-Monitore: (Automatisches Halten)

```

707 #define SW_DHTXX
    
```

Listing 6.58. DHT11, DHT22 und kompatible Feuchtigkeits- und Temperatursensoren

```

717 //##define SW_R_E24_5_T /* E24 5% tolerance, text */
718 //##define SW_R_E24_5_CC /* E24 5% tolerance, color-code */
719 //##define SW_R_E24_1_T /* E24 1% tolerance, text */
720 //##define SW_R_E24_1_CC /* E24 1% tolerance, color-code */
721 //##define SW_R_E96_T /* E96 1% tolerance, text */
722 //##define SW_R_E96_CC /* E96 1% tolerance, color-code */
723 //##define SW_R_E96_EIA96 /* E96 1% tolerance, EIA-96 code */
    
```

Listing 6.59. Widerstand auf Übereinstimmung mit dem Normwert der E-Reihe prüfen

```

732 //##define SW_C_E6_T /* E6 20% tolerance, text */
733 //##define SW_C_E12_T /* E12 10% tolerance, text */
    
```

Listing 6.60. Kondensator auf Übereinstimmung mit dem Normwert der E-Reihe prüfen

```

742 //##define SW_L_E6_T /* E6 20% tolerance, text */
743 //##define SW_L_E12_T /* E12 10% tolerance, text */
    
```

Listing 6.61. Induktivität auf Übereinstimmung mit dem Normwert der E-Reihe prüfen

```

752 //##define SW_CONTINUITY_CHECK
    
```

Listing 6.62. Durchgangsprüfung

```

761 #define SW_R_TRIMMER
    
```

Listing 6.63. Zeigt zusätzliche Informationen zu einem möglichen Potentiometer/Trimpot an

```

769 //##define SW_C_VLOSS
    
```

Listing 6.64. Zeigt den Selbstentladungs-Spannungsverlust (in %) eines Kondensators > 50nF

```

777 #define SW_PHOTODIODE
    
```

Listing 6.65. Fotodioden-Test

```

786 //##define SW_DIODE_LED
    
```

Listing 6.66. Dioden/LED-Schnellprüfung

```

797 //##define SW_METER_5VDC
798 #define METER_5VDC_THRESHOLD 25 /* default threshold in 100 mV */
    
```

Listing 6.67. Voltmeter 0-5 V DC

6.4.4. Benutzer Einstellungen

```
877 #define UI_ENGLISH
878 // #define UI_BRAZILIAN
879 // #define UI_CZECH
880 // #define UI_CZECH_2
881 // #define UI_DANISH
882 // #define UI_FRENCH
883 // #define UI_GERMAN
884 // #define UI_ITALIAN
885 // #define UI_POLISH
886 // #define UI_POLISH_2
887 // #define UI_ROMANIAN
888 // #define UI_RUSSIAN
889 // #define UI_RUSSIAN_2
890 // #define UI_SPANISH
```

Listing 6.68. Sprachwahl, hier ist Englisch vorgewählt

```
898 #define UI_COMMA
```

Listing 6.69. Benutzung von Strich statt Punkt

```
906 // #define UI_FAHRENHEIT
```

Listing 6.70. Temperaturen in Fahrenheit anstelle von Celsius anzeigen

```
917 // #define UI_PREFIX
```

Listing 6.71. 4-stellige Werte als Wert mit metrischem Präfix anzeigen (falls zutreffend)

```
925 // #define UI_HEX_UPPERCASE
```

Listing 6.72. Hexadezimale Werte in Großbuchstaben statt Kleinbuchstaben anzeigen

```
934 #define UI_AUTOHOLD
```

Listing 6.73. Standard-Betriebsmodus Auto-Hold

```
943 // #define UI_AUTOHOLD_FOUND
```

Listing 6.74. Wechselt vorübergehend in den Auto-Hold-Modus, wenn ein Bauteil erkannt wird

```
952 #define UI_SHORT_CIRCUIT_MENU
```

Listing 6.75. Menüaufruf durch Kurzschluss aller drei Testpins

```
960 // #define UI_MAINMENU_POWERON_BUTTON
```

Listing 6.76. Hauptmenü nach dem Einschalten durch zweimaliges Drücken aufrufen

```
968 #define UI_SKIP_FIRST_PROBING
```

Listing 6.77. Überspringen den ersten Abtastzyklus nach dem Einschalten

```
979 #define UI_KEY_HINTS
```

Listing 6.78. Hinweise anstelle des Cursors, falls verfügbar

```
987 // #define UI_CHOOSE_PROFILE
```

Listing 6.79. Einstellungsprofil - nach dem Einschalten auszuwählen

```
995 // #define UI_THREE_PROFILES
```

Listing 6.80. ein drittes Profil für Anpassungswerte

```
1004 // #define UI_SERIAL_COPY
```

Listing 6.81. Ausgabe über serielle TTL-Schnittstelle

```

1014 // #define UI_SERIAL_COMMANDS
      Listing 6.82. Bedienung des Testers über serielle TTL-Schnittstelle

1023 #define CYCLE_DELAY 3000
      Listing 6.83. Maximale Wartezeit nach dem Testen (in ms)

1036 #define CYCLE_MAX 5
      Listing 6.84. Maximale Anzahl von Testläufen ohne gefundene Bauteile

1045 #define POWER_OFF_TIMEOUT 30
      Listing 6.85. Automatisches Abschalten wenn eine Weile keine Taste gedrückt wird (in s)

1055 #define SW_SYMBOLS
      Listing 6.86. Pinbelegung mit Bauteilsymbolen für 3-Pin-Halbleiter

1064 // #define UI_PINOUT_ALT
      Listing 6.87. Alternative Pinbelegung

1073 #define UI_QUESTION_MARK
      Listing 6.88. Anzeige Fragezeichensymbol bei fehlgeschlagenem Testlauf

1082 // #define UI_ZENER_DIODE
      Listing 6.89. Anzeige Zener-Dioden-Symbol bei der Zener-Prüfung

1091 #define UI_QUARTZ_CRYSTAL
      Listing 6.90. Erweiterter Frequenzzähler: Anzeige des Quarzsymbols für LF/HF-Modi

1100 // #define UI_ONEWIRE
      Listing 6.91. DS18B20/DS18S20/DHTXX: Anzeige des Sensorsymbols

1109 // #define UI_NO_TEXTPINOUT
      Listing 6.92. Abschalten der textbasierten Pinbelegung für 3-Pin-Halbleiter

1117 // #define UI_NO_BODYDIODE_TEXTPINOUT
      Listing 6.93. Deaktivieren der textbasierten Pinbelegung der inneren Diode für MOSFETs

1128 // #define UI_BATTERY
      Listing 6.94. Batteriestatus: Anzeigesymbol

1136 #define UI_BATTERY_LASTLINE
      Listing 6.95. Batteriestatus: Anzeige in der letzten Zeile nach der Anzeige des Messergebnisses

1146 // #define UI_PROBE_REVERSED
      Listing 6.96. Anzeige von Testpin-IDs mit umgekehrten Farben

1157 // #define UI_PROBE_COLORS
      Listing 6.97. Farbcodierung für Testpins

1167 // #define UI_COLORED_TITLES
      Listing 6.98. Farbiges Titel

```

```
1177 #define UI_COLORED_CURSOR
```

Listing 6.99. Buntes Cursor- und Tasten-Hinweise

```
1188 #define UI_COLORED_VALUES
```

Listing 6.100. farbige Werte

```
1198 //#define UI_MENU_PAGEMODE
```

Listing 6.101. Menüs: seitenweises Blättern im Menü statt positionsweises Blättern

```
1206 //#define UI_MAINMENU_AUTOEXIT
```

Listing 6.102. Hauptmenü automatisch verlassen

```
1214 #define SW_POWER_OFF
```

Listing 6.103. Menüpunkt Ausschalten

```
1226 //#define SW_FONT_TEST
```

```
1227 //#define FONT_PACKED /* packed output format */
```

Listing 6.104. Hauptmenü: Anzeige der Schriftart für Testzwecke

```
1236 //#define SW_SYMBOL_TEST
```

Listing 6.105. Anzeige von Komponentensymbolen zu Testzwecken

```
1255 #define UI_CENTER_ALIGN
```

Listing 6.106. Infos und einige andere Texte mittig ausrichten

```
1264 //#define UI_PROBING_DONE_BEEP
```

Listing 6.107. Bestätigungssignal, wenn die Sondierung abgeschlossen ist

```
1273 //#define UI_TEST_PAGEMODE
```

Listing 6.108. Selbsttest/Justierung: Messwerte seitenweise anzeigen

```
1282 //#define UI_PROBES13_RCL
```

Listing 6.109. Automatische Auslösung des RCL-Monitors an den Sonden Nr. 1 und Nr. 3

```
1293 #define DATA_FLASH /* store data in Flash */
```

Listing 6.110. Speicherung von Firmware-Daten (Texte, Tabellen usw.)

6.4.5. Energieverwaltung

```
1312 #define POWER_SWITCH_SOFT
```

```
1313 //#define POWER_SWITCH_MANUAL
```

Listing 6.111. Typ des Leistungsschalters

```
1324 //#define BAT_NONE
```

```
1325 //#define BAT_DIRECT
```

```
1326 #define BAT_DIVIDER
```

Listing 6.112. Batterieüberwachungsmodus

```
1339 //#define BAT_EXT_UNMONITORED
```

Listing 6.113. Optionale externe Stromversorgung ohne Überwachung

```
1349 #define BAT_R1    10000  
1350 #define BAT_R2    3300
```

Listing 6.114. Spannungsteiler zur Batterieüberwachung

```
1361 #define BAT_OFFSET 290
```

Listing 6.115. Spannungsabfall durch Verpolungsschutzdiode und Transistor (in mV)

```
1370 #define BAT_WEAK   7400
```

Listing 6.116. Spannung für schwache Batterie (in mV)

```
1379 #define BAT_LOW    6400
```

Listing 6.117. Spannung für leere Batterie (in mV)

```
1387 #define SAVE_POWER
```

Listing 6.118. Schlafmodus für geringeren Stromverbrauch

6.4.6. Messeinstellungen und Offsets

```
1400 #define UREF_VCC   5001
```

Listing 6.119. ADC-Spannungsreferenz basierend auf Vcc (in mV)

```
1411 #define UREF_OFFSET 0
```

Listing 6.120. Offset für die interne Spannungsreferenz (in mV): -100 bis 100

```
1421 #define R_LOW      680  
1422 /* Rh in Ohms */  
1423 #define R_HIGH    470000
```

Listing 6.121. Genaue Werte der Testwiderstände

```
1434 #define RH_OFFSET  350
```

Listing 6.122. Offset für systematische Fehler der Widerstandsmessung mit Rh (470 k) in Ohm

```
1445 #define R_ZERO     20
```

Listing 6.123. Widerstand der Testpins/-kabel (in 0,01 Ohm)

```
1454 // #define R_MULTIOFFSET
```

Listing 6.124. Widerstandsoffset für einzelne Testkabel-Paare

```
1470 #define C_ZERO     43
```

Listing 6.125. Kapazität der Testpins/-kabel (in pF)

```
1479 // #define CAP_MULTIOFFSET
```

Listing 6.126. Test-Kabelpaar spezifische Kapazität Test-Kabelpaar spezifische Kapazität

```
1487 #define CAP_DISCHARGED 2
```

Listing 6.127. Maximale Endladespannung für Kondensatoren (in mV)

```
1499 #define CAP_FACTOR_SMALL 0 /* no correction */  
1500 #define CAP_FACTOR_MID -40 /* -4.0% */  
1501 #define CAP_FACTOR_LARGE -90 /* -9.0% */
```

Listing 6.128. Korrekturfaktoren für Kondensatoren (in 0,1 %)

```
1509 #define ADC_SAMPLES 25
```

Listing 6.129. Anzahl der ADC-Runden für jede Messung

```
1520 // #define ADC_LARGE_BUFFER_CAP
```

Listing 6.130. 100nF AREF-Puffer-Kondensator

```
1535 // #define LCD_READ
```

Listing 6.131. Lesefunktionen für das Anzeigemodul aktivieren

```
1546 // #define SW_DISPLAY_ID
```

Listing 6.132. ID des Anzeige-Controllers lesen

```
1556 // #define SW_DISPLAY_REG
```

Listing 6.133. Liest Register des Display-Controllers und gibt sie über TTL seriell aus

6.4.7. Busse

```
1618 // #define I2C_BITBANG      /* bit-bang I2C */
1619 // #define I2C_HARDWARE     /* MCU's hardware TWI */
1620 // #define I2C_STANDARD_MODE /* 100kHz bus speed */
1621 // #define I2C_FAST_MODE     /* 400kHz bus speed */
1622 // #define I2C_RW             /* enable I2C read support */
```

Listing 6.134. I2C-Bus

```
1634 // #define SPI_BITBANG      /* bit-bang SPI */
1635 // #define SPI_HARDWARE     /* hardware SPI */
1636 // #define SPI_RW            /* enable SPI read support */
1637 // #define SPI_SLOWDOWN      /* slow down bit-bang SPI */
```

Listing 6.135. SPI-Bus

```
1648 // #define SERIAL_BITBANG   /* bit-bang serial */
1649 // #define SERIAL_HARDWARE  /* hardware serial */
1650 // #define SERIAL_RW          /* enable serial read support */
```

Listing 6.136. OneWire bus

```
1659 #define ONEWIRE_PROBES    /* via probes */
1660 // #define ONEWIRE_IO_PIN    /* via dedicated I/O pin */
```

Listing 6.137. TTL serial interface

6.5. Config_328.h

enthält hardwarenahe Einstellungen für Anzeigen, Tasten und so weiter. Es handelt sich auch wieder um eine C-Header-Datei, d.h. es gelten die Kommentar-regeln für C. Neben dem “//“ für einzelne Zeilen werden auch Blockkommentare mittels “#if 0 ... #endif“ verwendet. Um einen Block ein kommentieren, einfach ein “//“ vor dem entsprechenden “#if 0“ und “#endif“ einfügen; zum Auskommentieren der umgekehrte Weg. Man kann einen Block auch ein kommentieren, indem man die Zeilen mit dem “#if 0“ und “#endif“ löscht.

6.5.1. Notwendige Änderungen für Display

```
629 #if 0
630 #define LCD_ST7565R          /* display controller ST7565R */
```

Listing 6.138. Aktives LCD ST756R Modul deaktiviert

```
672 #endif
```

Listing 6.139. Aktives LCD ST756R Modul deaktiviert

```
681 //#if 0
682 #define LCD_ST7735          /* display controller ST7735 */
```

Listing 6.140. LCD_ST7735 aktiviert

```
687 #define LCD_PORT    PORTD    /* port data register */
688 #define LCD_DDR      DDRD     /* port data direction register */
689 #define LCD_RES      PD0      /* port pin used for /RESX (optional) */
690 #define LCD_CS       PD5      /* port pin used for /CSX (optional) */
691 #define LCD_DC       PD1      /* port pin used for D/CX */
692 #define LCD_SCL      PD2      /* port pin used for SCL */
693 #define LCD_SDA      PD3      /* port pin used for SDA */
```

Listing 6.141. Pin Zuordnung anpassen

```
695 #define LCD_DOTS_X 128      /* number of horizontal dots */
696 #define LCD_DOTS_Y 160      /* number of vertical dots */
697 //#define LCD_OFFSET_X 4      /* enable x offset of 2 or 4 dots */
698 //#define LCD_OFFSET_Y 2      /* enable y offset of 1 or 2 dots */
699 #define LCD_FLIP_X        /* enable horizontal flip */
700 //#define LCD_FLIP_Y        /* enable vertical flip */
```

Listing 6.142. horizontales drehen ein kommentieren

```
703 //#define LCD_LATE_ON      /* turn on LCD after clearing it */
```

Listing 6.143. Für Beginn mit einem leerem Display Kommentar deaktivieren

```
705 //#define FONT_8x16_ALT_HF    /* 8x16 alternative font */
706 //#define FONT_10X16_HF        /* 10x16 font */
707 //#define FONT_6X8_IS08859_2_HF /* 6x8 Central European font */
708 //#define FONT_8X8_IS08859_2_HF /* 8x8 Central European font */
709 #define FONT_8X12T_IS08859_2_HF /* thin 8x12 Central European font */
710 //#define FONT_8X16_IS08859_2_HF /* 8x16 Central European font */
711 //#define FONT_10X16_IS08859_2_HF /* 10x16 Central European font */
```

Listing 6.144. Wähle eine Schriftart.Du kannst auch eine andere hinzufügen

die sich im Bitmaps-Verzeichnis befindet. Alle Fonds, die HF am Ende haben, sind möglich.

```
714 #define SYMBOLS_24X24_HF    /* 24x24 symbols */
715 //#define SYMBOLS_30X32_HF    /* 30x32 symbols */
716 //#define SYMBOLS_30X32_ALT1_HF /* 30x32 alternative symbols #1 */
717 //#define SYMBOLS_30X32_ALT2_HF /* 30x32 alternative symbols #2 */
718 //#define SYMBOLS_32X32_HF      /* 32x32 symbols */
719 //#define SYMBOLS_32X32_ALT1_HF /* 32x32 alternative symbols #1 */
```

Listing 6.145. Hier kannst Du aus Symbole hinzufügen

In der Zeile 714 wurde eine Symbolreihe der Größe 24x24 Pixel aus dem Verzeichnis hinzugefügt.

Hinweis: Je größer die Zeichen sind, desto mehr Speicherplatz wird verbraucht und desto weniger Platz bleibt für Optionen.

727 // #endif

Listing 6.146. Kommentieren am Ende nicht vergessen

6.5.2. Notwendige Änderungen für Drehgeber und Optionen

```
950 #define ENCODER_PORT PORTD /* port data register */
951 #define ENCODER_DDR DDRD  /* port data direction register */
952 #define ENCODER_PIN PIND /* port input pins register */
953 #define ENCODER_A PD1   /* rotary encoder A signal */
954 #define ENCODER_B PD3   /* rotary encoder B signal */
```

Listing 6.147. Einstellung der Spuren des Drehkoders

```
961 #define KEY_PORT  PORTD /* port data register */
962 #define KEY_DDR   DDRD  /* port data direction register */
963 #define KEY_PIN   PIND  /* port input pins register */
964 #define KEY_INC   PD1   /* increase push button (low active) */
965 #define KEY_DEC   PD3   /* decrease push button (low active) */
```

Listing 6.148. Einstellung Drehrichtung (auf/ab)

```
973 #define COUNTER_PORT PORTD /* port data register */
974 #define COUNTER_DDR  DDRD  /* port data direction register */
975 #define COUNTER_IN  PD4   /* signal input T0 */
```

Listing 6.149. Einstellung Zähler Eingang

```
973 #define RINGTESTER_PORT PORTD /* port data register */
974 #define RINGTESTER_DDR  DDRD  /* port data direction register */
975 #define RINGTESTER_OUT PD5   /* pulse output */
```

Listing 6.150. Klingeltester Ausgang

```
994 #define IR_PORT    PORTC /* port data register */
995 #define IR_DDR     DDRC  /* port data direction register */
996 #define IR_PIN     PINC  /* port input pins register */
997 #define IR_DATA    PC6   /* data signal */
```

Listing 6.151. IR-Detektor/Decoder

Der gleicher Pin wird auch verwendet für:

Summer	řádky 1074 - 1076
MAX6675	řádky 1083 - 1085
MAX31855	řádky 1092 - 1094
Taschenlampe	řádky 1110 - 1112

6.5.3. Information Diese Einstellung wurde so gewählt, damit ein Vergleich der Versionen möglich war. Zum aktivieren von anderen Funktionen in der m-Version, musst du, für dich unwichtige, Optionen in der v config.h deaktivieren und andere Optionen dafür aktivieren.

Software	m-version 1.52m
Clone Name	AY AT Clone
Program	98,2 %
Data	12,1 %
EEPROM	2,1 %

Tabelle 6.2. Data für aktivierte m-Software für GM328A

Bemerkung: falls zu viele Optionen, **zu viel Platz** im ATmega 328, fördern, zum Beispiel bei dem Versuch in der config_328 bei dem LCD Modul auf Seite ?? Zeile 754 font 10x16_HF zu aktivieren,... erscheint ... nach dem ... **Aufruf** **make**...:

```
/usr/lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld: ComponentTester section `.text' will not fit in region `text'
/usr/lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld: region `text' overflowed by 2234 bytes
collect2: Fehler: ld gab 1 als Ende-Status zurück
make: *** [Makefile:198: ComponentTester] Fehler 1
bohu@fuji-w:/media/bohu/Programme/Elektronik/TTester/GM328A/GM328a_52m$
```

Abbildung 6.1. hier wird die Gier, durch den Compiler bestraft ;-)

nach der Änderung auf font 8x12T_ISO8859_2_HF sieht es schon viel besser aus:

```
AVR Memory Usage
-----
Device: atmega328

Program:    32166 bytes (98.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)

Data:        248 bytes (12.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)

EEPROM:     22 bytes (2.1% Full)
(.eprom)

bohu@fuji-w:/media/bohu/Programme/Elektronik/TTester/GM328A/GM328a_52m$
```

Abbildung 6.2. nun reicht es : **make upload**
 a ... die Operation war erfolgreich. Ctester ist jetzt persönlich und „unbezahlbar“.
Vergiss nicht den Selbstset, Selbstabgleich und da nach... die Ergebnisse im Speicher abzulegen!
 nach dem Kapitel ?? ab Seite ??.

Um die Verzweiflungen und „schlaflose Nächte“, die Schreiber dieses Dieses Kapitels erlitten hatte, nach dem er, ohne jegliche AVR Erfahrung, einen Clonetester erworben hatte und diesem die deutsche Sprache „beibringen“ wollte, anderen Kollegen zu ersparen, wurde dieses Kapitel geschrieben.

Die hier bei erworbene Erfahrungen sollten anderen „willigen“ unerfahrenen helfen,
ERFOLGREICH ihr Tester zu programmieren.

Diese Gelegenheit wird benutzt, dem Autor und Entwickler des Transistortester
Karl-Heinz Kübbeler siehe [?] zu danken für sein Engagement und Geduld,
denn die folgenden Seiten hätten ohne seiner Hilfe nie entstanden.

Damit das übersetzen der Firmware und Brennen ins MCU gelingt und gleichzeitig ...
„das Rad nicht neu erfunden sein müsste“, wurde ein Teil der folgenden Seiten aus dem
Beschreibung des Transistor Tester von Karl-Heinz Kübbeler siehe [?] übernommen.

Also noch einmal ... EINEN RIESEN DANK.

7.1. Konfigurieren des Component Testers

Dazu bitte Kapitel ?? ab der Seite ?? lesen.

7.2. Programmierung des Mikrocontrollers

Die Programmierung des Testers wird über die Datei Makefile gesteuert.

Die Makefile stellt sicher, dass die Software entsprechend der vorher in der Makefile eingestellten Optionen übersetzt wird.

Das Ergebnis der Übersetzung hat die Dateierweiterung .hex und .eep.

Üblicherweise heißen die Dateien ComponentTester.hex und ComponentTester.eep.

Die .hex-Datei enthält die Daten für den Programmspeicher (Flash) des ATmega-Prozessors.

Die .eep-Datei enthält die Daten für den EEPROM des ATmega.

Beide Dateien müssen in den richtigen Speicher geladen werden.

Zusätzlich muss der ATmega mit den „fuses“ richtig konfiguriert werden.

Wenn Sie das Makefile zusammen mit dem Programm avrdude [?] benutzen, brauchen Sie keine genaue Kenntnis über die Einzelheiten der fuses.

Sie brauchen nur „make fuses“ aufrufen, wenn Sie keinen Quarz benutzen oder Sie müssen „make fuses-crystal“ aufrufen, wenn Sie einen 8MHz Quarz auf der Baugruppe installiert haben.

Wenn Sie sich nicht sicher mit den fuses sind, lassen Sie diese erst einmal wie vom Werk gesetzt und bringen Sie den Tester in diesem Zustand zum Laufen.

Es kann sein, dass das Programm zu langsam läuft, wenn Sie die für den 8MHz-Betrieb erzeugten Programmdaten benutzen, aber das kann man später korrigieren!

Aber falsch gesetzte fuses können die spätere ISP-Programmierung verhindern.

7.3. Betrieb System Linux

Die Programmierung unten Linux bringt viele Vorteile, weil dieses OS von Experten entwickelt wurde, die sich auf den Wünschen der Benutzer orientieren. Zu dem ist die Umgebung kostenlos erhältlich und perfekt gewartet.

Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit von OS selbst aber auch beim nutzen des Internets.

Die heutigen Editionen lassen sich noch viel leichter bedienen als die Mitbewerber OS.

Diese Anleitung soll alle „nicht“ Linux Benutzer dazu animieren es NUN zu testen in dem sie ihr Tester damit programmieren.

Als Beispiel wird hier Linux Mint in der aktueller Version benutzt, die im Internet zu erhalten ist. Die Installation ist auf verschiedene Arten möglich.

7.4. Benutzung unter Linux

auf neu installierten OS.

Für diejenigen, die nicht gerne schreiben, bietet Linux eine einfachere Möglichkeit.

Dieses Handbuch auf einen USB-Stick kopieren und im Linux öffnen.

Danach die Maus zum Namen des Dokumentes führen, hier linke Maustaste drücken und das Dokument bis zum linken Rand des Bildschirms ziehen, bis ein ein mögliches Rahmen angezeigt wird. Nun wird die Maus losgelassen.

Die Anleitung nimmt nun die linke Hälfte des Bildschirms ein.

Im nächsten Schritt werden **Strg** + **Alt** + **t** gleichzeitig gedrückt, um das Befehlsfenster zu öffnen. Dies wird nun auf gleicher Weise zum rechten Rand des Bildschirmes bewegt.

7.5. Programm Pakete installieren

Nun brauchen wir einen Internetzugang.

Um den Tester zu programmieren, müssen zuerst Programmpakete installiert werden:

'binutils-avr', 'avrdude', 'avr-libc' und 'gcc-avr'. Weiter die Versionsverwaltung 'git'.

Jetzt in diesem Dokument zu dieser Seite, bis zu diesem Text navigieren:

`sudo apt-get install avrdude avr-libc binutils-avr gcc-avr git`

den Text mit gedrückter linken Maustaste markieren, die Maus auf das Kursor des rechten Befehlsfenster führen und durch drücken der mittleren Maustaste (Scroll-Rad) **weiter als [MT]** abgekürzt wieder einfügen.

Nach dem Bestätigung mit **Enter**, wird von 'sudo' noch Benutzerpassword verlangt.

Damit werden nun alle Software Pakete durch 'apt' herunter geladen und installiert.

U.U. muss man dazwischen, Fragen durch **J** bestätigen.

Bitte darauf achten, das im Linux zwischen Groß und Kleinschreibung unterschieden wird.

Also nicht mit **j** sondern mit **J** antworten!

Ob die Versionsverwaltung 'git' erfolgreich installiert wurde, kann man mit dem Kommando:

`git version`

überprüfen. Das Programm sollte mit der Ausgabe seiner Versionsnummer antworten.

7.6. Download der Quellen

und der Dokumentation aus dem Git-Archiv wird erreicht mit einer Anweisung:

`git clone https://github.com/kubi48/TransistorTester-source`

Die Dateien sind nun in dem Linux [Persönlicher Ordner] auf (/home/„user“) unten dem Namen „TransistorTester-source“.

Die Kontrolle des Vorhandensein. Teminal Fenster öffnen,

`ls`

und mit **Enter** oder **↓** bestätigen.

Um neue Updates heruntergeladen, reicht es in der Zukunft:

`cd ~/Tra`

gefolgt von **Tab** und **↓** eingeben, und nun im diesem Verzeichnis

`git pull`

einzugeben gefolgt von **↓**.

Hinweis: Bei Problemen oder Fehlermeldungen ist es am einfachsten, den vorhandenen Ordner 'TransistorTester-source' löschen oder umzubenennen und dann mit dem oben benanntem Anweisung neu downloaden.

7.7. Benutzung der Schnittstellen

für den Nutzer (user) vorbereiten.

USB-Geräte können durch Eingabe von 'lsusb' im Befehlsfenster erkannt werden. Geben Sie 'lsusb' zuerst ohne und dann mit angeschlossenem USB-Programmer ein.

Ein Vergleich der Ergebnisse lokalisiert den USB-Programmer.

Das Ergebnis von lsusb kann so aussehen:

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 058: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Bus 002 Device 059: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub}
```

Hier wurde als Device 58 ein AVR ISP mkII erkannt (DIAMEX ALL-AVR).
Die ID 03eb ist eine Herstellerkennung und die ID 2104 eine Produktkennung.
Diese beiden Kennungen werden der Datei /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules benötigt und erstellt

mit Hilfe von:

```
sudo xed /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

In diesem Beispiel besteht die Datei 90-atmel.rules aus einer Zeile:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0660",  
GROUP="plugdev"
```

Dieser Eintrag erlaubt den Zugriff auf das Gerät für Mitglieder der Gruppe „plugdev“.

Um bekannte Programme nutzen zu können, ist folgendes Text in 90-atmel.rules empfohlen:

```
# Copy this file to /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules  
# AVR ISP mkII - DIAMEX ALL-AVR  
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0660",  
GROUP = "plugdev",  
# USB ISP-programmer für Atmel AVR  
SUBSYSTEM=="usb", ENV {DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS {idVendor}=="16c0", MODE="0666",  
SYSFS {idProduct} == "05dc",  
# USBasp programmer  
ATTRS {idVendor}=="16c0", ATTRS {idProduct}=="05dc", GROUP="plugdev", MODE="0660"  
# USBtiny programmer  
ATTRS {idVendor}=="1781", ATTRS {idProduct}=="0c9f", GROUP="plugdev", MODE="0660"  
# Pololu programmer  
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="1ffb", MODE="0666"
```

Nach dem die Datei erstellt wurde, kann die Erstellung und Inhalt kontrollieren mit:

```
less /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

Das ebenfalls als Device 59 erkannte USB Gerät Arduino SA Mega 2560 System erzeugt eine Zugriffsmöglichkeit auf das serielle Gerät „/dev/ttyACM0“ für Mitglieder der Gruppe 'dialout'.

7.8. Gruppen Mittgliedschaft

Deswegen sollte die eigene Benutzerkennung sowohl Mitglied der Gruppe 'plugdev' als auch der Gruppe 'dialout' sein. Das Kommando:

```
sudo usermod -a -G dialout,plugdev $USER
```

sollte die Zugehörigkeit sicherstellen. Jetzt sollte ein Zugriff mit avrdude auf beide Geräte möglich sein. Kontrollieren kann man es mit dem Kommando: 'id'.

Sollten Probleme auftreten kann man die Mitgliedschaft auch über:

Menü > Systemverwaltung > Benutzer und Gruppen > ?Passwort, nun erscheint ein Fenster mit zwei Reitern.

Wenn man nun im Reiter **Benutzer** auf sein Name klickt, sieht man rechts sein Profil und die Gruppen Zugehörigkeiten. Mit dem Button **Hinzufügen** ist nun Möglich neue Gruppen hinzufügen.

7.9. Arbeitsumgebung

Vorbereitung.

Zu erst in der Taskleiste mit Ordnersymbol (Nemo) zum /TransistorTester-source/Markus/navigieren, mit der rechten Maustaste auf ComponentTester-1.(höchste Nr.)m.tgz klicken, in der Auswahl <hier entpacken> der Ordner Dekomprimieren und Nemo schließen. Damit das Original erhalten bleibt und weil sich das Terminalfenster immer in ../home/ "user" öffnet, wird empfohlen, dort sein Arbeitsverzeichnis mit dem Namen **Mytester** zu verlegen.

Mit der schon bekannten Methode folgendes Verzeichnis markieren, und im Terminal Fenster mir mittlerer Taste einfügen.

```
cd ~/TransistorTester-source/Markus/
```

Nach dem Bestätigen und Kommando: 'ls' sieht man alle gepackten Ordner (Endung.tgz) und nur ein Ordner wo diese Endung fehlt -> also unserer (vorher ausgepackter) Ordner.

Bei den folgenden zwei Kommandos, diese zuerst **NUR** einfügen, **ohne Enter** zu drücken: !

```
cp -r 'MyT' Mytester/
```

Das Verzeichnis des benötigten Models mit der Maus markieren.

Nun den blinkender Kursor mit Hilfe von **[←]** zur letztem Zeichen des Text 'MyT' positionieren und diese Zeichen löschen. Nach dem das letzte Zeichen gelöscht wurde, die **[MT]** Taste der Maus drücken. Erst jetzt **[Enter]** benutzen. Damit ist die Arbeitsumgebung erstellt. Die Kontrolle der Existenz und Inhalts ist möglich mit:

```
diff 'MyT' Mytester/
```

vobei muss 'MyT', wie vorher, für das Verzeichnis des „benötigten Testers Models“ ausgetauscht werden. Mit dem letzten Anweisung:

In -s ~/TransistorTester-source/Markus/Mytester ~/Mytester wird die Verknüpfung zum Arbeitsverzeichnis erstellt.

Ab jetzt erreicht man dieses Verzeichnis sehr einfach mit:

```
[Strg]+[Alt]+[t], cd [Leertaste] My [Tab] [Enter]
```

und schon ist man in benötigten Verzeichnis. Mit 'ls' sieht man den Inhalt.

Weiter geht es zum bearbeiten von Makefile mit, inzwischen bekanntem Anweisung:

```
xed Ma [Tab] [Enter]
```

Hier ist am wichtigsten, den VORHANDENEN USB-Programmer anmelden.

Siehe dazu im Kapitel ??, auf der Seite ??, Thema PROGRAMMER.

7.10. Firmware erzeugen und übertragen

Nach dem Editieren vom Makefile, config.h und config-<MCU>.h bitte „make“ ausführen oder Dein IDE, um die Firmware zu übersetzen. Als Ergebnis werden zwei Dateien erzeugt:

- ComponentTester.hex Firmware im Intel-Hex-Format
- ComponentTester.eep EEPROM-Daten im Intel-Hex-Format

Die Firmware wird in das Flash geschrieben und die EEPROM-Daten in das EEPROM.

Die Daten enthalten zwei Sätze an Standardabgleichswerten, Texte und Tabellen.

Wenn Du bei der Aktualisierung der Firmware die alten Abgleichswerte im EEPROM beibehalten möchtest, kann Du mit dem Schalter DATA_FLASH in config.h die Texte und Tabellen in die Firmware verschieben.

In diesem Fall muss dann **nur** die Firmware in das Flash geschrieben werden; das EEPROM bleibt unverändert.

Das Makefile bietet folgende Targets:

make clean	alle Objektdateien löschen
make	zum Übersetzen des Programms
make fuses	Fuse-Bits setzen (via avrdude)
make upload	Firmware und EEPROM-Daten brennen (via avrdude)
make prog_fw	nur Firmware brennen (via avrdude)
make prog_ee	nur EEPROM-Daten brennen (via avrdude)

Hinweise zu Compiler/Linker-Optimierungen:

Im Makefile gibt es mehrere Zeilen von CFLAGS und LDFLAGS mit Compiler und Linker-Optionen. Daneben gibt es auskommentierte Zeilen mit zusätzlichen Optimierungsoptionen, welche die Größe der Firmware reduzieren können, aber nicht von allen Compilern unterstützt werden.

Hier ist Experimentieren angesagt. ;)

Hinweise zu speziellen Einstellungen im Makefile:

- In einer Linux/Unix-Umgebung kann OPTIMIZE_VECTORS aktiviert werden, um die Interruptvektortabelle zu optimieren und damit die Firmwaregröße zu reduzieren.

7.11. Arbeitsumgebung vereinfachen

Hier bietet sich an, ein neues Textdokument zu erstellen und hinein den richtigen Pfad einfach von dem Terminal Fenster zu kopieren. Zu dem kannst du in den deine oft benutzte Befehle einschreiben, damit du sie bei der Hand hast. Der Vorgang ist folgend:

Drücke gleichzeitig [Strg] + [Alt] + [t] und kopiere dahin folgendes Befehl:
xed r-Version.txt [Enter]

und ein neues Dokument ist erstellt und geöffnet. Hinein kopiere die nächsten Zeilen:

```
cd TransistorTester-source/trunk/mega328_color_kit/
```

```
xed Makefile
```

```
make clean
```

```
make
```

```
make fuses-crystal
```

```
make upload
```

- Und deine weitere Bemerkungen. Nun musst du es nur auf der Arbeitsfläche speichern.

Nun bleibt nur die Freude über das erreichter Erfolg.

7.12. Nötige Hardware zum Programmieren

Für die Anfänger die noch nichts besitzen gelten die folgende Informationen.

7.12.1. Programmer braucht unten Linux kein Treiber. Du musst ihm lediglich, wie im Teil ?? und in der Makefile ?? korrekt einstellen.

Ein großer Vorteil von 'avrduude' ist, das es mit preiswerten Programmer zufrieden ist, der du schon unten 2 Euro bekommst.

2- Satz, Kabel 10 Polig (ist nicht auf dem Bild),

1- Pololu etwa (13 Euro) Adapter 6x10 Pins und USBasp zusammen unten (2 Euro)

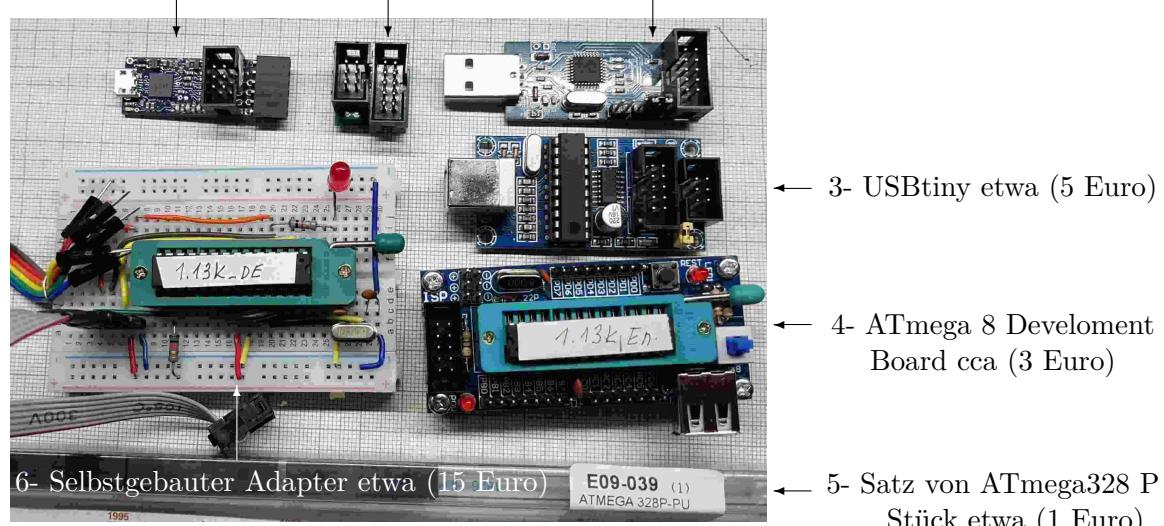


Abbildung 7.1. Hardware

Wie du aus dem Bild ?? entnehmen kannst, brauchst du nur
(2)- Programmer

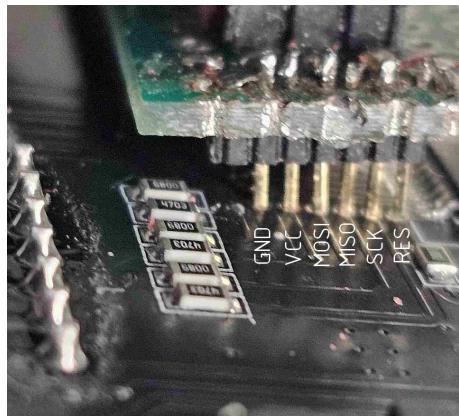
(4)- kleine Entwicklungsplatine

(5)- und für Sicherheit Ersatz ATmega 328 P.

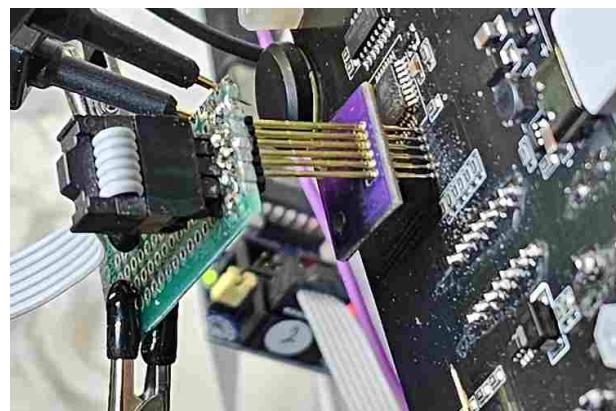
Das alles, bekommst du, zusammen für unten 10 Euro.

Natürlich, kannst auch deine Umgebung, wie unten (6) selbst bauen, falls du aber die darin benutzten Teile noch kaufen musst, lohnt es sich nicht.

Für die „neue“ verlötete Version braucht man einen Adapter, wie Abgebildet



(a) Zuordnung



(b) Adapter

Abbildung 7.2. GM328A „neu“ Umprogrammieren

Die Hardware für den Bau des Adapters bekommst du z.B. bei:

- Platine: <https://de.aliexpress.com/item/1005003441037826.html>
oder: <https://de.aliexpress.com/item/1005002906951475.html>
Nadel Befestigung: <https://de.aliexpress.com/item/1005007473592589.html>
und dazu: <https://de.aliexpress.com/item/1005006196394613.html>
oder Nadel: <https://de.aliexpress.com/item/1005006165528951.html>
Anschluss: <https://de.aliexpress.com/item/1005005364262476.html>
Kabel: <https://de.aliexpress.com/item/1005004762590129.html>
und zum Löten: <https://de.aliexpress.com/item/1005007884660384.html>

Gutes Gelingen ;-)

Model	GM 328 A
Größe	78 x 63 x 28 mm
Bauart	SMD
AVR	ATmega 328P
Quarz	8 MHz
Anzeige	ST7735 (128 x 160 Pixel)
IDE möglich	nein
Bedienung	Impulsdrehgeber mit Taster
Spannungsversorgung	9V Netzteil oder 9V E-Block
Verbrauch Betrieb	
Verbrauch Standby	20 nA
Messspannung	5V
Messstrom	6 mA
Bestimmung und Messung	Transistoren, MOSFET, JFET, P-IGBT, Dioden,
Bestimmung und Messung	Zenerdioden bis 5V, Thyristoren und Triacs
Bestimmung und Messung	Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Quarzen
Frequenz Messung	1 Hz - 2MHz
Frequenz Generierung	1 Hz - 2MHz
Generierung von Impulsen	Festfrequenz von 7,8 kHz; Impulsbreite 1% - 99%
Spannungsmessung	0V - 50 V DC
Bereich Widerstände	0,01 -
Bereich Kondensatoren	1pF - 100mF
Bereich Spulen	0,01mH -

Tabelle 8.1. Technische Daten

8.1. Hilfe

kannst du im deutschem Forum versuchen [?].

Änglisches Forum erreichst du auf [?]

und fallst du slowakisch beherrscht auf [?].

8.2. Und für Entspannung

oder für die Beschäftigung deines Nachwuchs: [?].

8.3. Schema GM 328 A

Folgendes Schema zeigt eine Bauteileverbindung **ohne Garantie** auf Vollständigkeit.

Das Schema besitzt keinen Maßstab.

Eingebaute Bauteile wurden mit diesem Tester bestimmt. Bei den Kondensatoren war die Bauteilebestimmung nicht möglich.

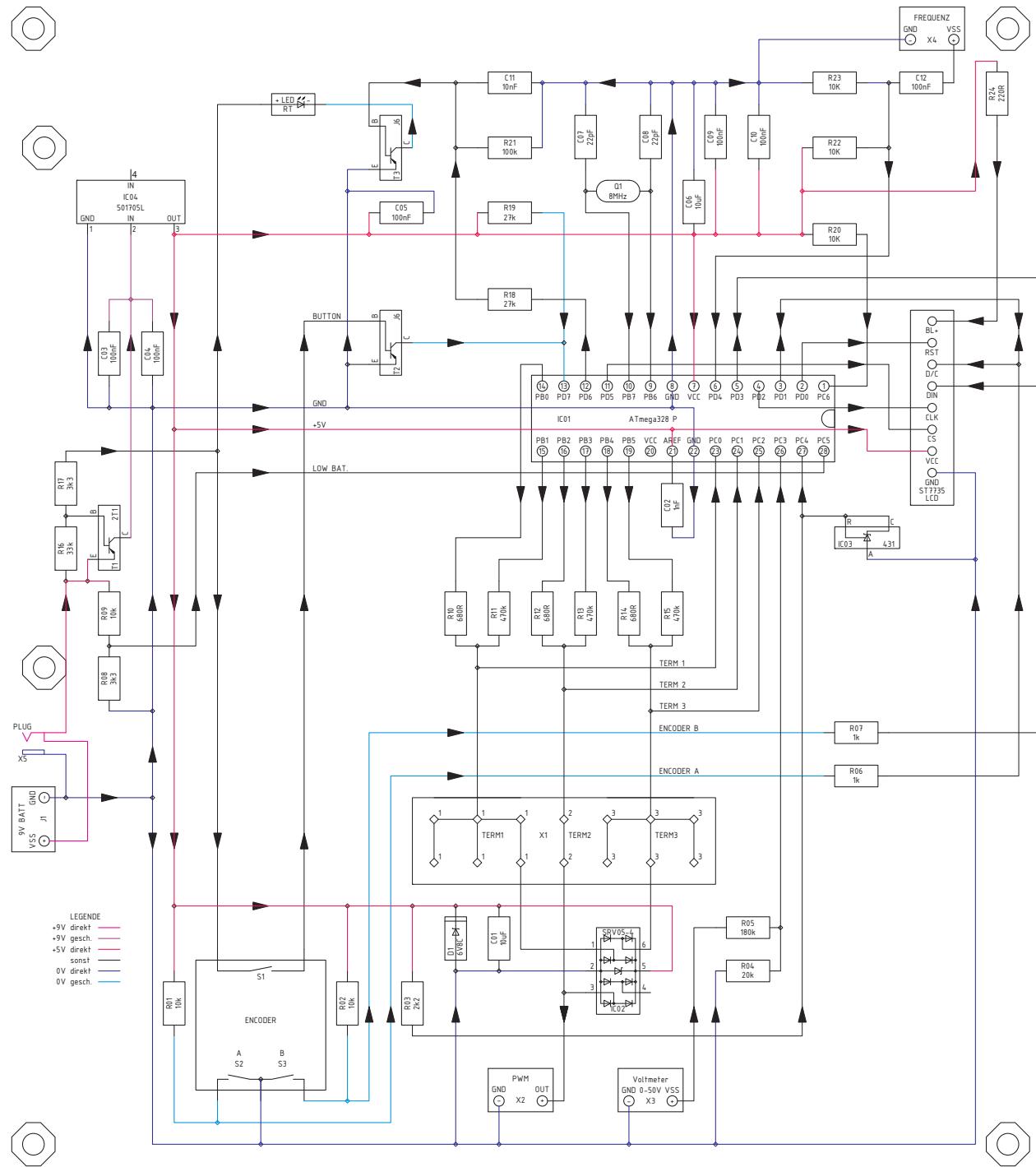


Abbildung 8.1. Schema Bauteile Verbindungen

Wie es sichtbar ist, wäre sehr einfach möglich, den zweipoligen PWM Stecker (X2) für ein drei-poligen auszutauschen um Festanschluss von Testkabeln zu realisieren.

Literaturverzeichnis

- [1] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>
Online Dokumentation des Transistortesters, Online Article, 2009-2011
- [2] <https://github.com/kubi48/TransistorTester-documentation>
Aktuelle Anleitung zum Transistor Tester
- [3] <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>
Komplette Software Sammlung
- [4] <https://github.com/kubi48/TransistorTester-source>
Komplette Software Sammlung
- [5] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDUDE>
Online Dokumentation avrdude IDE
- [6] <https://www.mikrocontroller.net/topic/248078>
Hauptsprache ist Deutsch, Englisch ist auch ok.
- [7] [https://www.eevblog.com/forum/\\$20-lcr-esr-transistor-checker-project/](https://www.eevblog.com/forum/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/)
Nur Englisch.
- [8] <https://svetelektro.com/> *Všetko zo sveta elektroniky*
Ein Slowakisches Elektronik Portal seit 2006
- [9] <https://dragaosemchama.com/en/2017/01/rex/>
Spiel Tetris für den Tester und weitere Infos